

46
2er.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE QUIMICA



EXAMENES PROFESIONALES
FAC. DE QUIMICA

SINTESIS Y CARACTERIZACION DE SOLUCIONES
SOLIDAS DE LiTaO₃ Y LiNbO₃ CON Nd³⁺ Y Dy³⁺

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

Q U I M I C O

P R E S E N T A :

MARTIN DANIEL TREJO VALDEZ

L



MEXICO, D. F.

1997.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Jurado asignado:

Presidente: Prof. MEJUEIRO MOROSINI MERCEDES

Vocal: Prof. CASTELLANOS ROMAN MARIA ASUNCIÓN

Secretario: VILLAFUERTH CASTREJÓN MARÍA ELENA

1er. SUPLENTE: Prof. CHAVEZ MARTINEZ MARGARITA

2do. Suplente: Prof. GUTIERREZ AMADOR MARÍA DEL PILAR

Sitio donde se desarrolló el tema:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES (UNAM).

Maria Elena Villafuerte
Dra. MARÍA ELENA VILLAFUERTH CASTREJÓN
Asesor de tema de tesis

Daniel Trejo Valdez
MARTIN DANIEL TREJO VALDEZ
Sustentante.

ÍNDICE

	Página
OBJETIVO	5
INTRODUCCIÓN	5
BASES TEÓRICAS	12
• Rayos-X	12
• Producción de Rayos-X	12
• Ecación de Bragg	14
• Determinación de estructura de compuestos y materiales	15
• Difracción de polvos	18
Defectos en sólidos	21
Las soluciones sólidas	23
• Soluciones sólidas sustitucionales	23
• Soluciones sólidas intersticiales	24
• Cationes intersticiales	24
• Vacancias catiónicas	24
• Vacancias catiónicas-aniones intersticiales	24
• Sustitución doble	25
PARTE EXPERIMENTAL	26
• Síntesis de las soluciones sólidas	26
• Caracterización de las series de soluciones sólidas	27
• Patrones de difracción de polvos de las series obtenidas	33
• Determinación de las densidades experimentales de los compuestos de la series de soluciones Sólidas	35

RESULTADOS	36
• Discusión	60
CONCLUSIONES	61
BIBLIOGRAFÍA	62
Anexo 1 Patrones de difracción y sus tablas	64
Anexo 2 Tablas de tratamientos térmicos	86

OBJETIVO.

El objetivo de éste trabajo es el encontrar los intervalos de solubilidad de los cationes Nd^{3+} y Dy^{3+} en LaTaO_3 y LiNbO_3 , y proponer un mecanismo de reacción para la formación de sus series de soluciones sólidas. Caracterizar cristalosquímicamente los compuestos derivados de la formación de soluciones sólidas, para dar las bases que apoyen en un futuro cercano a la investigación de sus potenciales propiedades ferroeléctricas y ópticas.

INTRODUCCIÓN.

La interrelación entre el fenómeno eléctrico y óptico es el objeto de una ciencia aplicada llamada optoelectrónica (tambien llamada ópticaelectrónica o fotónica), la cual resulta de la conjugación de campos de la ciencia e ingeniería óptica, electrónica y materiales. Esta cubre diversos tópicos como electrotomismo, electroluminiscencia, física de lasers, celdas solares y detectores de luz, dando así las bases para el desarrollo de tecnología en comunicaciones, defensa, energía y computadoras. Un particular y fundamental aspecto de la optoelectrónica es la electroóptica y se refiere específicamente a los cambios locales inducidos por un campo eléctrico en los parámetros ópticos de los materiales (índice de refracción y coeficiente de absorción) llamados efectos Kerr Y Pockells

En general un sistema ópticoelectrónico se compone de los siguientes conjuntos:

Generación de la señal óptica. \Rightarrow **Control y manipulación.** \Rightarrow **Detección y Visualización de señales.**

El primer bloque involucra la generación de la señal óptica y puede incluir un láser diodos emisor de luz (LED), o una fuente de luz convencional. En el segundo bloque esta el control y manipulación de la señal óptica e incluye dispositivos como switches, moduladores, deflectores, multiplexers, dobladores de frecuencia etc. Finalmente el tercer bloque se refiere a la detección y la forma en que se muestra la señal. Los tres bloques anteriores dependen enormemente del fenómeno óptico.

Los diodos lasers o LEDs, convierten una señal óptica en una emisión de luz coherente o incoherente el correspondiente mecanismo electroóptico es llamado entonces activo. El control y manipulación de la luz depende de el fenómeno electroóptico pasivo, no implica generación de luz. Aquí se incluyen mecanismos locales como los efectos de Pockells y Kerr así como aquellos que involucran procesos de transporte de cargas como electrocrómica y efectos fotoeléctricos. Finalmente la detección de luz requiere la conversión de una señal óptica a una señal eléctrica y también involucra efectos fotoconductivos, fotoeléctricos o fotovoltaicos, hay en cierta forma el inverso de operación de el conjunto uno. En resumen, la electroóptica juega un papel clave en todos los apartados de un sistema optoelectrónico.

El primer descubrimiento de el fenómeno electroóptico data de los primeros experimentos de John Kerr reportados en 1875. Kerr estudió la birefringencia inducida por un campo eléctrico en algunos líquidos como CsS y el vidrio (efecto Kerr). Esto fue un efecto reversible cuya magnitud es proporcional al cuadrado de el campo eléctrico. Curiosamente el efecto de primer orden fue descubierto en experimentos posteriores, hechos simultáneamente aunque de manera totalmente independiente, por Roentgen y Kundt en 1883 en cuarzo. Pockells propuso una explicación adecuada para esas observaciones lo que posteriormente se conoció como efecto Pockell.

Desde entonces muchos otros materiales han sido descubiertos e investigados como el KDP (KH_2PO_4), DKDP, LiNbO₃, BaTiO₃.

Los efectos (Pockell Y Kerr) entraron en Era de tecnología de la electroóptica casiamente en la década de 1950 cuando el uso de el KDP Y ADP (CaH_2PO_4) para la modulación e interrupción de la luz fue propuesto y demostrado. En dispositivos modernos el LiNbO₃ es el material de elección que puede alcanzar frecuencias de modulación de 10.100GHz.

Muchos dispositivos comerciales usan únicamente algunos materiales comunes en los que se incluye KDP, LiNbO₃ y cerámicos PLZT (de fórmula general $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x(\text{ZrTi})_3\text{O}_6$, de estructura tipo Perovskita) y algunos cristales líquidos. Esto es consecuencia de exigentes requerimientos para aplicaciones comerciales desafortunadamente el tamaño, perfección estructural y química y homogeneidad de muchos monocrystaltes (particularmente orgánicos) no alcanzan los estándares demandados. Consideraciones de costo también limitan el uso práctico de algunos materiales de interés. De cualquier forma, se esperan recientes avances en

diseño de materiales y caracterización, las cuales incrementen la lista dada arriba en un futuro cercano ofreciendo un intervalo mucho más amplio de opciones útiles.

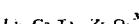
Los materiales electroópticos fotoconductivos presentan un fenómeno de bastante interés, conocido como el efecto fotorefractivo, con una variedad de aplicación en fotónica y óptoelectrónica. El efecto fue descubierto por Ashkin et al en 1966, como una degradación de un haz de láser al atravesar una pastilla de LiNbO₃ cuyas caras principales contiene el eje trigonal 3c del cristal¹. Si el haz es linealmente polarizable a lo largo de una dirección perpendicular al eje c (rayo ordinario), no aparece degradación. Por otra parte la polarización a lo largo del eje c (rayo extraordinario), el haz se expande a lo largo de este eje y da lugar a una mancha alongada de luz en una pantalla.

A partir del primer reporte el efecto fotorefractivo, un gran número de experimentos se han desarrollado en una variedad de materiales incluyendo aislantes inorgánicos, semiconductores y semiconductores superpuedes y compuestos orgánicos.

A temperatura ambiente el daño fotorefractivo inducido tiene un intervalo de persistencia de microsegundos o menos para semiconductores a meses para el LiNbO₃, de cualquier forma el daño es reversible en el sentido de que puede ser borrado por una iluminación intensa uniforme. Es así que, desde los primeros experimentos con LiNbO₃ y LaTaO₃, el efecto fotorefractivo es reconocido como sinónimo de almacenamiento de información para grabación de hologramas de fase volumen. El tiempo obscuro de almacenamiento (dark storage time) de estos hologramas a temperatura ambiente está dado simplemente por el tiempo dielectrónico de relajación (dark dielectric relaxation) τ . Usando un proceso llamado de fijación térmica se alcanza hasta un tiempo de 10^5 años (virtualmente infinito) entre los tiempos obscuros o luminosos a temperatura ambiente para el LiNbO₃. También utilizando una superposición selectiva de hologramas fijos se logra alcanzar altas memorias de densidad óptica en el mismo cristal dando una ventaja en el pronunciamiento angular y de selectividad de longitud de onda de volumen holográfico. Se han logrado grabar alrededor de 5000 hologramas, exhibiendo una eficiencia infima de difracción de aproximadamente 2.5% en su etapa final en una muestra de un $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ de LiNbO₃ con una longitud de onda de 448nm dando una capacidad de 0.5 Gbits/cm³.

Los monocristales de LiNbO₃ y LiTaO₃ poseen entonces propiedades que hacen que se centre en ellos un gran interés en el campo de la piezoelectricidad, piroelectricidad y electroóptica.

Por otra parte en diferentes trabajos se ha mostrado^{2,3,4} ya la posibilidad de modular esas propiedades por sustitución catiónica, encontrando series de soluciones sólidas con diferentes cationes introducidos en la red de LiTaO₃, por ejemplo, en las soluciones sólidas de LiTaO₃ con Ti⁴⁺ se encuentra que la temperatura de Curie decrece de su valor de 665 °C para LiTaO₃ puro hasta 360°C en la fase no estoquiométrica Li_{1-x}Ta_xTi_xO₃⁵ y 205°C en particular para el compuesto Li_{1-x}Ta_xZr_xO₃⁵, o cuando se introduce Zn y Ca en la red de LiTaO₃ el valor de Tc decrece hasta 330 °C para el límite más bajo (x = 0.02) de la solución sólida

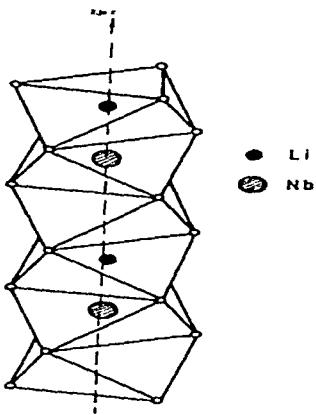


El LiTaO₃ es un buen material piroeléctrico, la importante disminución de su Tc asociada con el carácter difuso de transición de fase ferroeléctrica -paraelectrónica, le da un potencial interés en la aplicación de detectores para infrarrojo. Los detectores en IR hechos de LiTaO₃ tienen sensibilidades que son independientes de la temperatura en un amplio intervalo⁶, aunque su Tc (665 °C) sea bastante alta, para una mejor sensibilidad como detector en IR, la temperatura de Curie debe de ser cercana a la temperatura de operación, en éste sentido, si la temperatura de Curie pudiera reducirse a alrededor de 350°C, la eficiencia piroeléctrica puede optimizarse⁷. K.K. Deb⁸, encuentra en un estudio de sustitución catiónica para LiTaO₃ un conjunto de series como Li_{0.9}Ta_{0.1}Ti_{0.05}O₃ sintetizadas a baja temperatura vía metal alcotriido, que tienen la característica de presentar una Tc de 350 °C y sus propiedades dielectricas y térmicas se presentan en un intervalo deseable de temperatura de operación, ~30 °C-150 °C.

En éste tipo de soluciones sólidas también aparece un importante decremento en la temperatura de fusión, de 1650 °C para el LiTaO₃ puro a, por ejemplo 1460 °C para Li_{0.94}Ta_{0.06}Ti_{0.14}O₃, lo cual es una importante ventaja para el crecimiento de monocristales. Los monocristales de LiTaO₃ son estables e insolubles al grado de ser

comparados con el sulfato de triglicina (TGS) o el polifluoruro de vinilideno (PVF₂) que son buenos materiales piroeléctricos⁵.

La estructura del LiTaO₃ ha sido determinada por S.C. Abrahams⁶. Esta puede ser descrita como un ordenamiento de la estructura del corindón reemplazando a los dos Al³⁺ por un Li⁺ y un Ta⁵⁺. Esos cationes son localizados en dos terceras partes de los intersticios octaédricos del empaquetamiento hexagonal compacto de los oxígenos, que también puede verse como un apilamiento de octaedros unidos por las caras como se ve en el siguiente dibujo.



Estructura del LiNbO₃ mostrando el apilamiento de los octaedros de oxígeno a lo largo del eje c.(ref 1)

Jean Ravez et al⁷, en su estudio de soluciones Li_{1-x}Ta_xTi_yO₃ o, obtenidas apartir del LiTaO₃ por síntesis en estado sólido, proponen que los cationes en exceso se localizan en las vacantes octaédricas de la red de

Estructura del LiNbO₃, mostrando el apilamiento de los octaedros de oxígeno a lo largo del eje c (ref 1)

Jean Ravez et al⁶, en su estudio de soluciones Li_{1-x}Ta_{1.5x}Ti_{0.5}O₃ o, obtenidas apartir del LiNbO₃ por síntesis en estado sólido, proponen que los cationes en exceso se localizan en las vacancias octaédricas de la red de LiTaO₃. Para cada uno de sus materiales la variación térmica de la permutividad ϵ' , muestra un máximo el cual corresponde a una transición ferroeléctrica paraeléctrica. A temperatura ambiente, solo materiales ferroeléctricos y el vector de polarización espontánea del LiTaO₃ paralelo al eje c de la celda hexagonal se debe a los desplazamientos de los cationes a lo largo de esta dirección.

El LiNbO₃ es un cristal electroóptico, entre sus potenciales aplicaciones tecnológicas puede utilizarse como material para el almacenamiento de imagen e información, amplificación coherente óptica y "Phase-conjugation devices"⁷. Estas aplicaciones dependen del efecto fotorefractivo (LFR), el cual a su vez está relacionado con la aparición de algunas impurezas y/o defectos estructurales que actúan como donadores y接受ores de acarreadores electrónicos.

El LiNbO₃ se utiliza también como soporte en la elaboración de dispositivos en varios campos como electroóptica, acoustooptica, óptica no lineal, particularmente como guías de onda óptica, por medio de la difusión de un metal como el Ti en el LiNbO₃, y componentes pasivos en óptica integrada¹¹.

La estequiometría del LiNbO₃ influye en los defectos puntuales estructurales del cristal y por lo tanto influye en el comportamiento PTE, así como también en otras propiedades físicas¹². Es así, que se ha encontrado una dependencia de la Tc¹³, expansión térmica¹⁴, gap de energía¹⁵, y bandas de vibración de OH en materiales dopados con protones¹⁶, con la relación Li/Nb.

D.M. Kroll¹⁷ estudió las propiedades ópticas de el LiNbO₃ puro, mostrando que el comportamiento luminescente de este material era sensible a los cambios provocados por la variación Li/Nb en monocrystal y en muestras en forma de polvo preparadas con un exceso de La o Nb. En los estudios realizados por éstos investigadores concluyen que dada la ocupación cristalográfica única del Nb⁵⁺ en el LiNbO₃ atribuyen la banda de emisión ne el espectro a 520 nm, a una emisión de los grupos mohato, que, debido a la presencia de

los defectos introducidos en la red por la deficiencia de litio sufrieron una perturbación encontrando así la existencia de un segundo tipo de iones Nb^{5+} que ocupan el sitio dejado por el Li denominados defectos antisítio.

Lo anterior nos permite ver la importancia que tiene el estudio de las propiedades cristalográficas, dielectricas y ópticas de nuevos derivados de los compuestos no estoquiométricos del $LiTaO_3$ y el $LiNbO_3$ para la obtención de materiales que tengan un amplio número de aplicaciones.



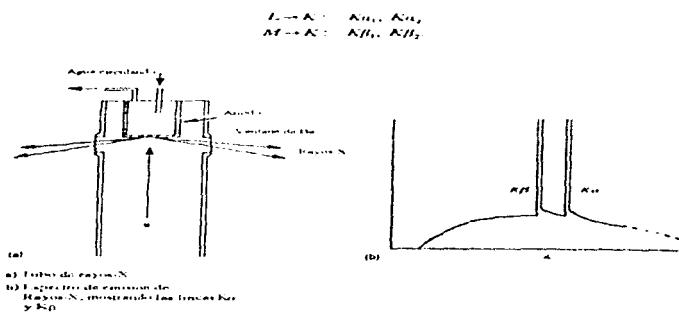
BASES TEÓRICAS.

Rayos-X

En el siglo XIX Abbe mostró que el uso de la microscopía óptica en el estudio de la estructura de la materia a nivel microscópico estaba intrínsecamente limitada a la longitud de onda de la radiación (luz), que se empleaba, y que solo una resolución significante podía ser encontrada usando una radiación con longitud de onda más pequeña. En particular es necesaria una longitud de onda de alrededor de 1 Å para analizar una estructura a nivel atómico, y el descubrimiento de los Rayos-X en 1895 felizmente provee una radiación con tal requerimiento.

Producción de Rayos-X

Los Rayos-X para experimentos de difracción son producidos por bombardeo a un blanco metálico, a menudo de Cu o Mo, con un haz de electrones emitidos de un filamento calentado como se muestra en el siguiente dibujo donde también se muestra un espectro típico de longitud de onda de Rayos-X contra intensidad (ref 19).



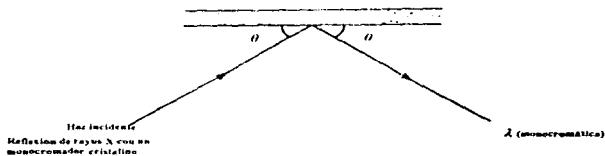
El haz incidente de electrones ioniza los electrones 1s (capa K) de los átomos del blanco metálico y los rayos X son emitidos cuando las vacancias resultantes se llenan por electrones de los niveles 2p (L) y 3s (M), esto da las líneas intensas $K\alpha$ y $K\beta$

$$L \rightarrow K: K\alpha_1, K\alpha_2$$

$$M \rightarrow K: K\beta_1, K\beta_2$$

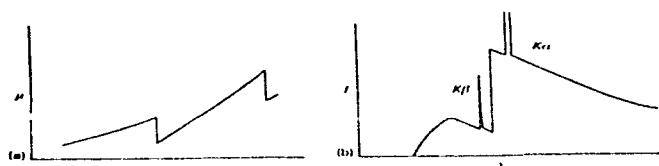
Cuando el número atómico del elemento blanco aumenta, la energía de las emisiones características se incrementa por ejemplo Cu $K\alpha = 1.54178\text{\AA}$ y su E= 8.04keV, Mo $K\alpha = 0.71069\text{\AA}$ y su E=17.44keV.

Podemos seleccionar un haz monocromático de cierta longitud $K\alpha$ reflejando un haz de rayos-X como se muestra en el siguiente esquema (ref 19)



donde de acuerdo con la ley de Bragg $\lambda = 2ds \operatorname{sen}\theta$.

La absorción de los Rayos-X obedece la ecuación $I=I_0 e^{-\mu t}$ donde μ es un coeficiente de absorción y t es la longitud de camino atraves del sólido. La variación del coeficiente μ con la longitud λ tiene la forma $\mu=\lambda^2$ (con $k = \text{cte}$) aunque hay discontinuidades o picos de absorción a energías que son suficientes para sacar un electrón del orbital atómico. El pico de absorción K se da a bajas longitudes de onda (altas energías) en la región de la línea $K\beta$ (ref 19).



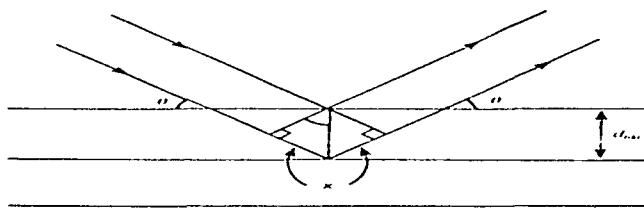
- a) Variación del coeficiente de absorción lineal, μ , con λ .
 b) Efecto del uso de filtros en el espectro de emisión de Rayos X.

Un filtro compuesto de elementos con $Z=1$, o $Z=2$ puede normalmente absorber la emisión $K\beta$ de un elemento con número atómico Z , por ejemplo se usa un filtro de Ni para radiaciones de cobre y un filtro de zirconio para radiación de Mo.

Ecuación de Bragg.

Ya se ha mencionado la utilidad de la ecuación de Bragg ahora veámos en que consiste.

La dispersión de Rayos-X en un cristal puede ser descrita como una reflexión de el conjunto de planos que componen la red. Basándose en el siguiente esquema:



donde:

La desviación del haz es 20.

La diferencia de camino es $2\lambda \cdot 2d_{\text{m}} \cdot \text{sen}(\theta)$

La interferencia constructiva (si los haces incidentes y reflejados se comportan como ondas) es $n\lambda + 2d_{\text{m}}\text{sen}(\theta)$ **n** es el orden de dispersión de los planos d_m . Las dispersiones de mayor orden ($n = 2, 3, \dots$) son indistinguibles de la dispersión de primer orden ($n = 1$) de los planos $d_m/2, d_m/3$ etc. Así que $\lambda \cdot 2d_{\text{m}}\text{sen}(\theta)$ es conocida como la ley de Bragg y representa la condición para que la difracción de haces se presente. La derivación de la ecuación está sobre simplificada, pero el resultado es que la ecuación puede ser aplicada a cristales de cualquier simetría.

Determinación de estructuras de compuestos y materiales.

Un cristal es un arreglo periódico de átomos en el cual las distancias interatómicas y los espaciamientos interplanares son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de los Rayos-X, por ejemplo las radiaciones $\text{K}\alpha$: $\text{Mo} = 0.711 \text{\AA}$, $\text{Cu} = 1.5418 \text{\AA}$ y $\text{Cr} = 2.291 \text{\AA}$; un cristal por lo tanto actúa como una rejilla de difracción tridimensional para los rayos-X, y hay tres ecuaciones (las ecuaciones de Laue) que deben ser satisfechas si hay interferencia constructiva de rayos-X. Las ecuaciones de Laue son:

$$a(\cos\phi_1 - \cos\phi_2) = b;$$

$$b(\cos\phi_2 - \cos\phi_3) = c;$$

$$c(\cos\phi_1 - \cos\phi_3) = a;$$

Las ecuaciones de Laue se obtienen como sigue, si consideramos a los átomos que son los centros dispersores de rayos-X, colocados sobre una línea y a intervalos de distancia, un centro de otro un tamaño b como se muestra en la figura Y. Los rayos-X que inciden sobre un centro lo hacen a un determinado ángulo ϕ_1 y saldrá dispersado a un ángulo que llamaremos ϕ_2 . Entonces la diferencia de camino entre rayos-X dispersados por centros (átomos) vecinos está dada por:

$$\delta_r = \Delta Q \cdot BP \dots a$$

o del dibujo Y 1 se puede ver también como

$$\delta_r = a(\cos\phi_2 - \cos\phi_1) \dots b$$

Pero para que la interferencia de los rayos-X sea constructiva esa diferencia de camino tiene que ser un número entero de longitudes de onda esto es

$$b(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) = k\lambda \quad (c)$$

La ecuación anterior se satisface para los generadores de un cono el cual es coaxial con la línea sobre la cual están situados los centros dispersores, y tiene un ángulo semi-vertical de φ_1 (fig. Y2). Entonces para una serie de valores de ángulo incidente φ_1 , debe haber un número de conos, y corresponderán a cada uno un orden de difracción k y un ángulo semivertical φ_2 .

Si esta explicación dada anteriormente se extiende a una red de centros dispersores (fig. Y3), para las líneas paralelas al eje X, se puede escribir, por analogía a la ecuación c

$$a(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) = b\lambda \quad (d)$$

Entonces cuando las ecuaciones c y d se satisfagan simultáneamente, como lo hacen a lo largo de las líneas de intersección (DR y BS de la figura Y3) de los dos conos, la red enterá dispersará en fase, produciendo un espectro lk. Para el caso particular que DR y BS coincidan, los rayos difractados caen dentro del plano de arreglo en dos dimensiones de centros dispersores. Ya generalizando a tres dimensiones es como se obtienen las tres ecuaciones de Laue

$$a(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) = h\lambda$$

$$b(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) = k\lambda$$

$$c(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_3) = l\lambda$$

Para el caso particular que los tres conos intersecten en una linea, el arreglo en tres dimensiones de centros dispersará en fase, produciéndose el espectro hkl-exímico correspondiente.

W.L. Bragg demostró que las ecuaciones de Laue son equivalentes a la condición para reflexión de los Rayos-X por el plano con índices hkl, enunciándolo en:

$$n\lambda = 2ds \sin \theta$$

que como ya se dijo es la ley de Bragg.

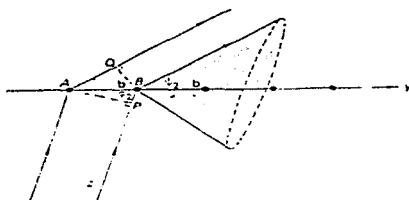


Figura Y1. Difracción en una línea de centros dispersores (ref. 23).

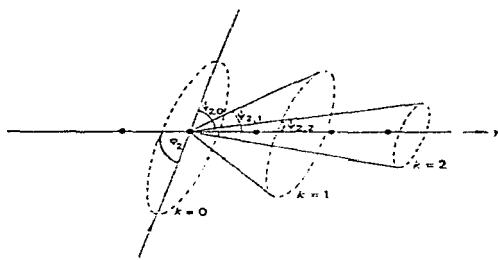


Figura Y2. Órdenes de difracción para una línea de centros dispersores (ref. 23).

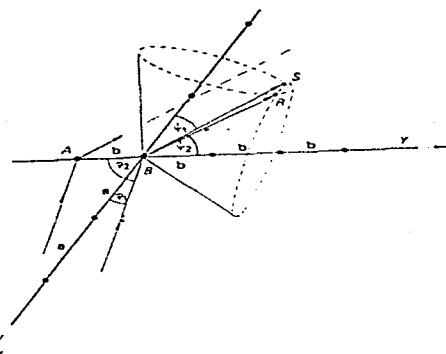


Figura Y3. Difracción en una red de centros dispersores (por claridad solo se dibuja una línea paralela a cada eje. (ref. 23)

Difracción de polvos:

La difracción de polvos es una herramienta poderosa para la identificación de las fases cristalinas y, para el análisis cualitativo y cuantitativo de las mezclas. Es usado para análisis de parámetros de celda unitaria y para determinar diagramas de fase (diagramas que muestran las fases estables presentes como una función de temperatura, y composición) están disponibles. Hay compilaciones de patrones comunes de difracción de polvos (en computadoras o libro) registradas por Joint Committee for Powder Diffraction Standards, Swarthmore, PA, USA. Es posible hacer una comparación del patrón de difracción de polvos obtenido experimentalmente con las más altas intensidades difractadas de algún patrón de difracción de polvos reportado, una búsqueda que puede hacerse por computadora y llega a revelar la composición química de un polvo. Así este método es de gran importancia industrialmente así como en investigación básica o aplicada.

Los métodos de polvos pueden ser usados para estudios estructurales simples. Hay ahora métodos sofisticados, originalmente introducidos por H.M. Rietveld en 1967, para el ajuste de parámetros dando una mejor aproximación con un patrón experimental de difracción.

Los resultados de la colección de los datos de difracción de rayos-X se refieren al pico o máximo de difracción que tenga la mayor intensidad, así todos los demás máximos de difracción estarán en la misma escala en el patrón de difracción. La posición angular a la cual se observa una radiación dispersada (relacionada al ángulo de dispersión 2θ) depende únicamente de las dimensiones del cristal, mientras que las intensidades de los haces difractados (algunas veces de la facilidad para calcular los parámetros geométricos y posibles correcciones de por absorción y otros efectos) únicamente en la naturaleza y arreglo de los átomos entre cada celda unidad. La intensidad dispersada a un ángulo puede calcularse de la suma de las diferentes ondas dispersadas por los diferentes átomos en la red; en otras palabras cada haz difractado contiene información de la estructura atómica del cristal.

En las determinaciones y formulaciones de estructuras de un compuesto dado, procedemos como sigue. Se obtiene una serie de líneas de difracción o patrón de difracción como el de el LiTaO₃, que se muestra en la figura 1.

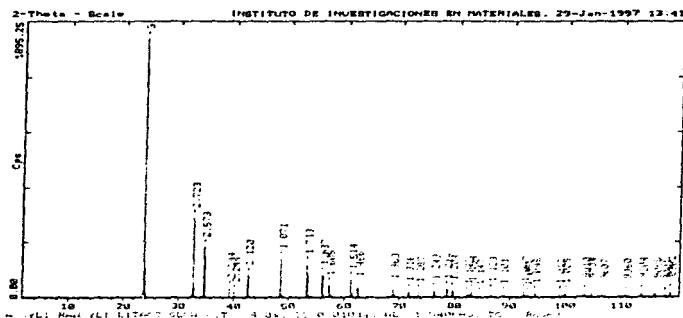


Figura #1. Patrón de difracción de rayos X de LiTaO₃. Sobre cada máximo se señala "d"

Se calcula entonces los valores de d, la distancia entre los planos adyacentes en la red cristalina usando la ecuación de Bragg. Las intensidades se leen en el patrón de difracción escaladas a la línea más intensa. Si no se conoce la naturaleza del material presente, entonces se puede utilizar el patrón obtenido para determinar la posible composición. Usando el conjunto de líneas de difracción, se toman las tres primeras líneas más intensas del patrón de difracción y referiéndose a "POWDER DIFFRACTION FILE" publicado por la INTERNATIONAL CENTRE FOR DIFFRACTION DATA 1601 Park Lane Shartimore, PA 19081-2389 USA , con la colaboración de la AMERICAN CERAMIC SOCIETY et al., se puede ver la composición más probable comparando estas tres líneas de nuestro patrón con las que allí se reportan. La tarjeta provee además información de como fue hecho el material y los componentes usados para sintetizarlo. Si no, se puede analizar por constituyentes.

Debido a la física geométrica del goniómetro de difracción del equipo de Rayos-X (el dispositivo que mide el ángulo de difracción), se obtienen valores de 2θ directamente. Entonces, los valores de (h,k,l) puede calcularse de fórmulas especiales desarrolladas para este propósito. Esas fórmulas las podemos ver en la siguiente tabla:

ESPAZAMIENTO DE PLANOS PARA VARIAS GEOMETRÍAS DE REDES	
CUBICA	TETRAGONAL
$\frac{1}{d^2} = (h^2 + k^2 + l^2)a^2$	$\frac{1}{d^2} = (h^2 + k^2 + l^2)a^2/c^2$
HEXAGONAL	ORTORÓMBICO
$\frac{1}{d^2} = 4/3(h^2 + k^2 + l^2)a^2 + l^2c^2$	$\frac{1}{d^2} = (h^2 + k^2)a^2 + (k^2 + l^2)c^2 + (l^2)a^2$
ROMBOEDRICA	
$\frac{1}{d^2} = (h^2 + k^2 + l^2)\sin^2\alpha + 2hk + kl + h\sin\alpha\cos\beta + k\cos\alpha\cos\beta$	$\frac{1}{d^2} = (1 - 3\cos^2\alpha + 2\cos^2\beta)$
MONOCLÍNICA	
$\frac{1}{d^2} = (1 + \sin^2\beta)(h^2 + k^2 + (k2\sin^2\alpha)l^2 + l^2c^2 + 2hl\cos\beta\alpha)$	
TRICLÍNICA	
$\frac{1}{d^2} = V(h^2 + \sin^2\alpha + k^2 + \sin^2\beta + l^2 + \sin^2\gamma + 2hk + 2kl + 2bc\sin\beta(\cos\alpha\cos\beta - \cos\gamma) + 2ka^2bc(\cos\beta\cos\gamma + 2kl^2bc(\cos\alpha\cos\beta))$	
donde V es el volumen de la celda. Los volúmenes de celda-unidad están dados por:	
Cubica $V = a^3$	hexagonal $V = (\sqrt{3}a^2c)/2 = 0.866a^2c$
Tetragonal $V = a^2c$	Monoclínica $V = abc\sin\beta$
Ortortómica $V = abc$	trícimica $V = abc\sqrt{(1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma)}$

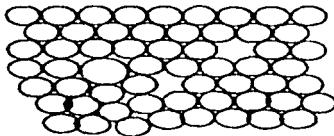
Notese que las ecuaciones para las redes de mayor simetría son más simples mientras que las dadas para las redes de menor simetría son complicadas. De nuestro ejemplo para el LiTaO₃, los valores de d, se calcularon con los valores de 2θ usando la ecuación de Bragg, para composición hexagonal.

DEFECTOS EN SÓLIDOS

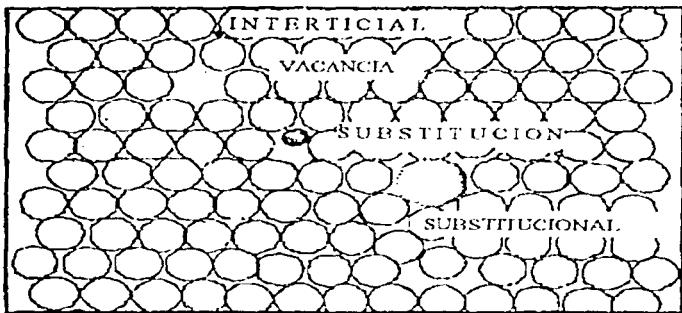
Un sólido (cristalino) es el resultado de considerar los aspectos geométricos de los átomos acomodados en su celda propagada al infinito. Si tomamos lo anterior en cuenta entonces un sólido perfecto deberá tener como resultado el no tener defectos. Así si los defectos son relacionados a la entropía del sólido, entonces un sólido perfecto deberá violar la tercera ley de la termodinámica, así que, todos los sólidos que encontramos son sólidos con defectos.

En un sólido tridimensional se pueden concebir 3 principales tipos de defectos, de una, dos y tres dimensiones. Ellos son llamados puntual, linea (borde), y volumen (plano) respectivamente. Los defectos puntuales son cambios a niveles atómicos, mientras que los defectos de linea y volumen son cambios en agregados de átomos (moleculas).

En particular los defectos de tipo puntual son los más interesantes, sin embargo existe un amplia bibliografía que presenta todo lo referente a los otros tipos de defectos¹⁷. Para visualizar los defectos puntuales podemos imaginar una red o balsa hecha de burbujas de jabón, la burbuja las tratamos de acomodar de manera que queden lo más cercanas unas a otras como se muestra en el siguiente esquema



En el esquema observamos una vacancia, esto es, una burbuja que se supone estar ahí, falta. También en el dibujo notamos el efecto de la "impureza" en el grado de ordenamiento. En nuestro dibujo la impureza es más grande. Entonces, ahora deberá de haber una compensación en la red, esto es todas las burbujas que rodean a la impureza son iguales y forman un empaquetamiento hexagonal compacto. A continuación en el siguiente dibujo podemos ver otros tipos de defectos (Ref. 17).



En el dibujo se ven tres tipos de defectos. En adición a la vacancia, se observan dos tipos de defectos substitucionales. Ambos son substituciones directas en la red o arreglo de los átomos. Uno es un atomo pequeño, mientras que el otro es un atomo más grande que los que están componiendo la red. Lo importante es ver la diferencia debida al tamaño de la impureza, sobre el ordenamiento en la red empacada hexagonalmente. Ahora toca el turno a el atomo intersticial que se acomoda por si solo en los intersticios de la red. Debe tenerse en cuenta que existe la posibilidad de contar con otros defectos d puntuales cuando tanto las especies cationicas y anionicas estén presentes en la red¹¹.

LAS SOLUCIONES SÓLIDAS.

Las podemos encontrar en los materiales cristalinos, una solución sólida es una fase cristalina que tiene composición variable*. Cuando una solución sólida se forma, algunas propiedades de los materiales como la conductividad, propiedades magnéticas, etc., se ven modificadas por el cambio en la composición.

Para fines didácticos, podemos pensar que las series de soluciones sólidas se derivan de dos tipos básicos. De las soluciones sólidas substitucionales, en las que el atomo que va a introducirse a la red, directamente reemplaza a un atomo de la misma carga, de las soluciones sólidas intersticiales, en las que las partículas introducidas ocupan un sitio que normalmente se encuentra vacío en la estructura cristalina.

Soluciones sólidas substitucionales.

En las soluciones sólidas substitucionales, por ejemplo las de $(Al_xCr_x)O_3$, 0.5:N:2, se observa que se cumplen ciertas características en su formación, siendo una de ellas, el que los iones que son reemplazados tienen la misma carga que los iones que los reemplazan (o de otro modo hay creación de vacantes intersticiales), en este ejemplo de solución se tiene Al^{3+} y Cr^{3+} . Otra característica que se encuentra experimentalmente en las aleaciones metálicas, es que la diferencia del radio de los átomos que se reemplazan unos con otros es del 15%. Para soluciones sólidas en sistemas no metálicos este intervalo varía ligeramente.*

Hay series de soluciones sólidas en el que las fases involucradas en su formación son isoestructurales, aunque, no debe de generalizarse que dos compuestos que los sean, darán necesariamente una serie de solución sólida (el LiF y CaO son isoestructurales y no son miscibles).

En un sistema donde los iones involucrados en la sustitución, son de tamaño considerablemente diferente, se encuentra que, el ion de mayor tamaño se reemplaza parcialmente, tal es el caso de los iones Na^+ sustituido por iones Li^+ en Na_2SiO_4 (a 800 °C) obteniéndose $Na_x(Li_2SiO_4)$, pero la sustitución ocurre únicamente en un 10%. Así, una solución sólida substitucional puede producir resultados de manera similar a los obtenidos de los defectos de Schottky en un cristal, solo que en este caso las vacantes aniónicas y catiónicas, no son enteramente balanceadas, sino ajustadas para mantener la electricidad neutralidad del cristal. Para comprobar si un modelo, ocurre de manera práctica, debemos de remitirnos a los resultados experimentales.

Soluciones sólidas intersticiales.

Un ejemplo clásico de este tipo de soluciones intersticiales y de gran importancia tecnológica es el γ -Fe de estructura C₈C (cúbico centrado en las caras), en el que los átomos de carbono se acomodan en los sitios octaédricos de la estructura. Se pueden mencionar ejemplos más complejos, cuando se considera la posibilidad de que el catión que va a sustituir a otro en un arreglo cristalino es de carga diferente. A partir de que la carga del catión sucesor sea mayor o menor a la del catión que saldrá se derivan cuatro posibles mecanismos que conformen la electroneutralidad de la red.

Vacancias catiónicas.

Si el catión que sale de la red tiene una carga menor que el catión que lo reemplaza, uno de los cambios que observa la red es la creación de vacancias catiónicas. Un caso conocido es el de la sustitución de dos cationes Na^+ por un ión Ca^{2+} en una red de NaCl. Empleando el sistema de notación de Kroger-Vink la fórmula de esta solución sólida la escribimos como $\text{Na}_{1-x}\text{Ca}_x\text{V}_x\text{Cl}_1\text{O}_x\text{N} \cdot 0.15$ (600°C), donde V_x es la vacancia.

Cationes intersticiales.

Otro de los cambios que puede observar la red en caso de que el catión que sustituye a otro sea de menor carga, es de creación de aniones intersticiales, quedando, el numero de cationes totales constante. Uno de los óxidos más estudiados desde esta perspectiva, es la forma rica en oxígeno del dióxido de uranio UO_2x , obtenida a partir del UO_2 con estructura tipo fluorita, en donde es razonable pensar que la no estquimetría se debe a los átomos de oxígeno puestos aleatoriamente en los sitios octaédricos restantes. Sin embargo, gracias a las grandes innovaciones de hoy en día de los métodos de análisis estructural, se encuentra que los átomos de oxígeno intersticiales no son puestos aleatoriamente en toda la estructura, sino que son arreglos en aglomerados locales con geometrías específicas.¹

Vacancias catiónicas, aniones intersticiales.

Girando nuestra atención ahora a la posibilidad de que el catión que entre a sustituir a otro en la red sea de menor carga, entonces, el balance de cargas que mantendrá a la red eléctricamente neutra, se debe al

mecanismo de creación de vacancias aniónicas o vacancias intersticiales (aunque claro en situaciones más complejas se puede dar una combinación de ambas).

Un ejemplo de solución sólida con vacancias aniónicas es la familia de soluciones $Zn_{1-x}Ca_xO_{2-x}$, 0.1 < x < 0.2, de gran importancia por sus propiedades refractarias, y en donde el número total de cationes en el proceso de sustitución permanece constante.

El mecanismo alternativo a la aparición de vacancias aniónicas en la red, es la creación de cationes intersticiales. Un buen ejemplo de esto lo da la formación de fases aluminio silicatos donde la estructura de el silice, ya sea cuarzo, tridimita o cristobalita, se modifica por un reemplazamiento parcial de Si^{4+} por Al^{3+} , y al mismo tiempo, cationes de metales alcalinos entran a ocupar sitios intersticiales vacíos en la estructura de el silice: $Li_xSi_{1-x}Al_xO_2$, 0 < x < 0.5.

Así, mientras que la sustitución de un tipo de átomo por otro de valencia diferente, puede derivar a defectos relacionados a el desorden de Schottky, la presencia de átomos ocupando posiciones intersticiales que normalmente se encuentran vacías, puede ser considerada de forma similar a los defectos de Frenkel. Así como con los defectos de Frenkel, la posibilidad de encontrar átomos intersticiales en el cristal, depende, de la apertura que tenga la estructura (a alojar o no a cationes nuevos) y el tamaño del cation que ingrese.

Substitución doble.

En algunos tipos de soluciones sólidas aparecen sustituciones simultáneas dobles. Esto se ve en los silátones, que son soluciones sólidas en el sistema Si-Al-O-N y su estructura se basa en la del Si_3N_4 . El nitrógeno de β -silicio se visualiza de tetraedros de SiN_4 unidos por los vértices dando así una estructura en tercera dimensión. Cada nitrógeno es de coordinación plana y forma la esquina de los tetraedros de SiN_4 . En estas soluciones sólidas, el Si^{4+} es reemplazado parcialmente por Al^{3+} y el ión N^3- se reemplaza parcialmente por O^{2-} .

PARTE EXPERIMENTAL.

SÍNTESIS DE LAS SOLUCIONES SÓLIDAS:

$\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_x\text{Nd}_3\text{O}_6$, $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_x\text{Nd}_3\text{O}_6$ y

$\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_x\text{Dy}_3\text{O}_6$, $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_x\text{Dy}_3\text{O}_6$

Las cuatro series de soluciones sólidas fueron obtenidas por reacción en estado sólido, método que se describe a continuación:

Como reactivos se usaron Li_2CO_3 (~ 99.9%), Nb_2O_5 (99.9%), Ta_2O_5 (99.99%), Nd_2O_3 (99.99%), Dy_2O_3 (99.99%), y obteniéndose en todos los casos como productos, polvos cristalinos.

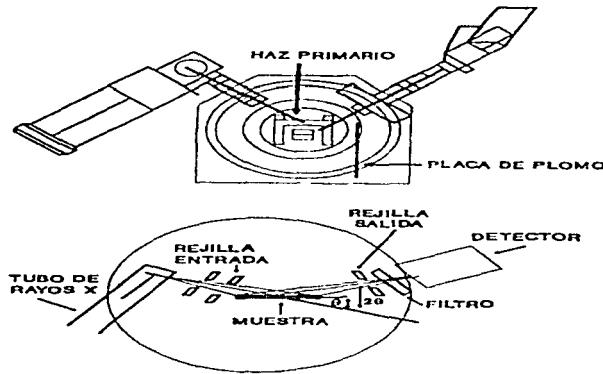
Las soluciones sólidas se prepararon calculando una proporción molar descrita por el diagrama de fases ternario correspondiente y en una cantidad total de aproximadamente 3 g, homogenizando la mezcla mecánica de los reactivos con acetona grado R.A., en un mortero de agata continuamente hasta asegurarse de una evaporación de acetona total. La mezcla mecánica perfectamente homogenizada, después se colocó en sendos crisoles de platino que se introdujeron en una mufla eléctrica Carbolite. Inicialmente las mezclas se calentaron a 600 °C-700 °C durante 2 horas, para desprendier el CO_2 del Li_2CO_3 , y finalmente la temperatura se elevó hasta un intervalo 900 °C-1200 °C, dando un tiempo para que reaccionaran de 30 a 40 días dependiendo de la composición de la muestra (1050 °C tanto para muestras con Nd y Dy). Las muestras al término del tiempo mencionado se sacaron de la mufla y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. El proceso se realizó a presión atmosférica.

Caracterización de las series de soluciones sólidas obtenidas.

Para identificar a cada uno de los productos de reacción, se recurrió a la difracción de rayos-X por el método de polvos, en el que mediante un haz monocromático de rayos-X que incide en una muestra de material molida en mortero de agata (que contiene cristales de aproximadamente 5nm y que muestra a todas las orientaciones posibles y los diferentes planos que componen la red, al menos en teoría), y se recogen los haces difractados por la muestra.

Para cada conjunto de planos orientados en el ángulo de Bragg θ los rayos difractados se detectan con un contador de centelleo conectado a una computadora, la cual da un gráfico de intensidad de haz difractado contra 2θ .

Para éste trabajo se utilizó un difractómetro Siemens D5000 con radiación de $\text{CuK}\alpha$ y con filtro de níquel que se muestra en el siguiente diagrama.



El material polícristalino montado en un portamuestras especial se coloca en una placa del equipo D5000, que se mueve con una velocidad angular alrededor de un eje común, el detector sigue simultáneamente la muestra con una velocidad angular de 20°/s. El detector transforma los cuantos de Rayos-X en pulsos eléctricos, que son contabilizados analógicamente, resultando un patrón de difracción. En el D5000 la superficie de la muestra está colocada a la mitad del ángulo entre el rayo incidente y el reflejado.

El equipo tiene incluido un sistema de colimadores entre el tubo de rayos X, la muestra, y el detector. El haz de rayos-X empleado es monocromático.

En el equipo, que utiliza radiación K_{α} , arriba del espectro con el uso de un filtro de radiación K_{β} , se coloca un monocromador entre el tubo de Rayos-X y la muestra (monocromador primario) y otro entre la muestra y el detector (monocromador secundario). Esto con el objetivo de tener una mejor resolución en cada una de las reflexiones registradas.

Las señales producidas, se obtienen en forma de gráficas (2θ en el eje X, e intensidad relativa de la señal en el eje Y), constituidas por series máximos de difracción bien definidos, que por el valor de 2θ e intensidad, nos dan el correspondiente valor de la distancia interplanar d , mediante el uso de la ley de Bragg.

Los espectros de difracción de LiLaO_3 y LiNbO_3 son isostucturales, solo muestran unas pequeñas diferencias. En las figuras 2 y 3 se presentan los espectros de LiLaO_3 y LiNbO_3 .

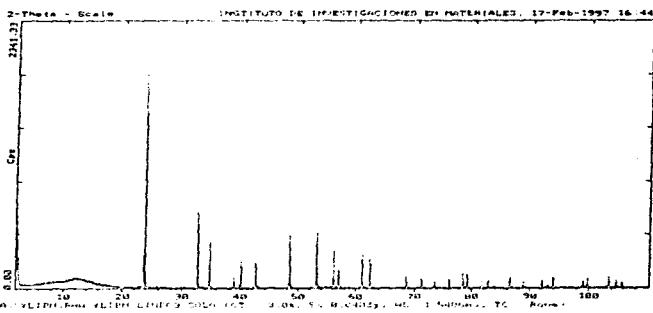
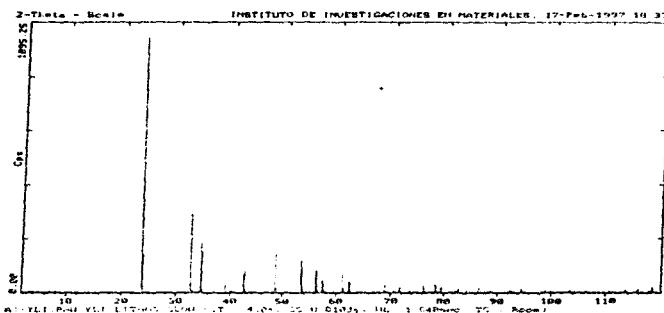
La velocidad de barrido del contador es normalmente de $2^{\circ}/20 \text{ min}$.

Las intensidades se determinan con las alturas de los picos, en general al pico más intenso se le atribuye un valor de 100 y el resto se mide de acuerdo con esta escala.

Para medidas más precisas de espacios interplanares d como es el caso de este trabajo, se emplea una velocidad de barrido menor (por ejemplo hasta de 1.10 o 2.0 mm^{-1}) y se aplica un estandar denominado interno (en este trabajo se usó KCl), que tiene que ser un material puro con un patrón de difracción simple y cuyos valores de d sean conocidos con precisión, por ejemplo KCl , NaCl , Al_2O_3 , SiO_2 , etc.

El estandar interno se mezcla con la muestra. El factor de corrección se obtiene de la discrepancia entre los valores observados y los valores de reales de d del estandar. Entonces este factor se aplica al patrón que va a medir.

Parte experimental



Figuras#2 y #3 Patrones de difraccion de rayos-X de LiTaO₃ y LiNH₄

Para medidas de intensidades relativas, el equipo utilizado cuenta con computadora integrada y diversos programas para múltiples aplicaciones.

El método de polvos identifica cuantitativamente los compuestos o fases cristalinas, pero no da información de la constitución química de estos.

Para la identificación de compuestos cristalinos, se utiliza el "Powder Diffraction File" (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Swarthmore, USA), conocido como el archivo JCPD, el cual contiene los patrones de polvos de más de 35000 materiales y, en un año, crece en un promedio de 2000 nuevas tarjetas y cuyo uso ya discutimos.

En figura 4, se muestran las tarjetas de La2O3 y LiNbO3, del archivero del JCPD.

Las tarjetas proporcionan los valores, en forma decreciente, de las distancias interplanares de las líneas de difracción, las correspondientes intensidades relativas y los índices de Miller, los datos de la radiación empleada, parámetros cristalográficos, alguna propiedades físicas del compuesto, fórmula, nombre químico.

La base de datos de la computadora del DS6000, cuenta con archivo JCPD hasta 1992.

Parte experimental

29-826 - JCPDS-ICDD Copyright (C) 1991. Ref.: 1-54054. Quality: *			
	2 theta [deg.]	N.R.I.	N.R.I.
LiTao 3			
	23.779	100	0 1 2
	22.960	42	0 0 4
	23.584	27	0 0 1
	23.776	4	0 0 0
	23.133	1	0 1 3
Adv. Conv.: Lampada: 5425W Filter: none. Diffract.:			
Calibr.: Int. Diffractometer. Filter: 1.00	42.359	14	0 0 2
Adv. with: Bur. Stand.: (2.0) Range: 14-20 (0.07)	49.872	26	0 0 4
	53.478	25	1 1 6
	54.027	24	1 2 2
	57.405	6	0 1 0
Spec. Sampled (cm): S.G.: 4.02 (1.03)			
At 5.100:	51.132	1	0 0 0
At:	51.725	1	0 0 0
At:	52.349	1	0 0 0
Ref. (Int.):	51.155	11	2 1 4
	52.219	6	0 0 0
	53.000	1	0 0 0
Det.: 7.000. Inc.: 55.070; FCF: 52.0; ODF: 4.01	51.748	2	1 2 10
	51.440	3	2 2 0
Ref.:	56.218	3	0 0 0
	58.458	4	1 1 2
	59.525	4	1 2 0
Unconf. type: Silicon carbide internal standard. PSC: HfO ₂ . To replace	62.264	2	0 2 10
1.001. Int.: 235.95. Volume(OD): 318.31.	62.798	4	1 1 4
	64.435	1	0 0 12
	66.455	1	2 2 6
	68.727	1	0 0 0
	72.492	2	2 1 19
	84.725	2	1 2 7
2-theta [deg.]	N.R.I.	2-theta [deg.]	N.R.I.
99.113	2	1 2 11	1
133.449	2	3 2 4	1
134.579	2	4 3 0	1

Strong Lines: 3.75/4 2.72/4 2.58/3 1.75/2 1.47/2 2.12/1 1.64/1 1.51/1

Figura # 4 Tarjeta JCPDS de LiTaO₃

Parte experimental

20-631 JCPDS-ICDD Copyright (c) 1991. Ref. # 3-54294. Quality: 6

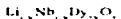
Línea	λ (Å)	θ (°)	2 theta (°)	intens.	R.H.S.
LiNbO ₃					
LITIUM NIOBATE					
Ref.: CSD#1 LITIUM NIOBATE	5.820	10.0	23.481	100	9 1 2
Cat#11 Int. Diffractionmeter 12/19/90			32.667	10	1 1 0 4
Ref.: Karr, Bur. Stand. 1941 Monogr. 29, p. 22 (1948)			34.738	20	8 0 0 8
			36.814	10	8 0 0 6
			40.058	10	1 1 1 3
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	42.327	10	7 0 2 2
at 3.1494	5.820	10.0	44.480	10	0 0 2 4
Al	5.820	10.0	52.712	20	1 1 1 6
Ref.: 101d			54.793	70	2 1 1 2
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	56.131	10	1 1 2 2
at 3.1494	5.820	10.0	56.131	8	0 0 2 2
Al	5.820	10.0	56.131	6	0 0 2 2
Ref.: 101d			57.192	10	3 0 0 3
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	57.192	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	57.192	1	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	58.325	4	2 0 0 4
Ref.: 101d			59.354	4	1 0 0 10
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	59.354	2	2 0 0 10
at 3.1494	5.820	10.0	60.392	2	2 2 2 3
Al	5.820	10.0	61.430	2	1 1 3 1
Ref.: 101d			62.472	8	3 1 2 2
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	62.472	4	2 0 0 4
at 3.1494	5.820	10.0	63.514	2	0 0 2 2
Al	5.820	10.0	63.514	1	0 0 2 2
Ref.: 101d			64.556	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	64.556	1	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	65.598	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	66.640	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			67.682	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	67.682	1	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	68.724	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	69.766	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			70.808	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	70.808	1	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	71.850	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	72.892	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			73.934	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	74.976	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	75.018	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	76.060	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			77.102	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	78.144	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	79.186	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	80.228	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			81.270	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	82.312	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	83.354	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	84.396	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			85.438	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	86.480	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	87.522	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	88.564	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			89.606	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	90.648	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	91.690	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	92.732	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			93.774	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	94.816	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	95.858	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	96.900	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			97.942	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	98.984	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	99.026	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	100.068	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			101.110	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	102.152	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	103.194	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	104.236	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			105.278	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	106.320	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	107.362	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	108.404	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			109.446	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	110.488	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	111.530	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	112.572	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			113.614	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	114.656	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	115.698	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	116.740	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			117.782	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	118.824	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	119.866	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	120.908	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			121.950	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	122.992	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	123.034	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	124.076	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			125.118	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	126.160	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	127.202	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	128.244	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			129.286	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	130.328	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	131.370	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	132.412	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			133.454	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	134.496	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	135.538	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	136.580	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			137.622	2	1 1 2 0
Si(111) Reference (hex) S.G. Fm-3m (161)	5.820	10.0	138.664	2	1 1 2 0
at 3.1494	5.820	10.0	139.706	2	1 1 2 0
Al	5.820	10.0	140.748	2	1 1 2 0
Ref.: 101d			141.790	2	1 1 2 0

Strong Lines: 3.159/4, 2.747/4, 2.591/2, 2.177/2, 1.881/2, 1.641/1, 2.752/1, 2.132/1

Figura # 4 (cont.) Tarjeta JCDP de el LiNbO₃.

Patrones de difracción de polvos de las soluciones sólidas obtenidas.

A continuación se enlistan las series de soluciones sólidas obtenidas:

SOLUCIÓN SÓLIDA**X-**

0; 0,0025; 0,005; 0,0075, 0,01

0; 0,0025; 0,005; 0,0075, 0,01

0; 0,0025; 0,005; 0,0075, 0,01

0; 0,0025; 0,005; 0,0075, 0,01

En el patrón de difracción de un compuesto se pueden identificar las fases presentes en él, en el patrón de difracción de una solución sólida obtenida, debemos de encontrar una sola fase presente, la del compuesto puro sin substituir, aunque debido a los cambios en el parámetro de la red, las líneas de intensidad de difracción tienen una variación en el valor de 2θ. Si la solución sólida sobrepasa su límite de solubilidad, el patrón de difracción dará señales correspondientes a una segunda fase (solución "saturada")

En las series de soluciones sólidas de LiTaO_3 y LiNbO_3 con Dy^{3+} y Nd^{3+} , se empleó como estandar interno el KCl y como referencia se seleccionó el máximo de difracción con $d = 66,385$ (figura 5)

El LiTaO_3 y LiNbO_3 , con celdas trigonal y hexagonal respectivamente cumplen la relación:

$$1/d^2 \approx 4/3 \{ (h^2 + k^2 + l^2)/a^2 \} + 2^2/c^2$$

Y con medidas previas de los máximos de difracción con índices de Miller (300) y (208), se obtienen los valores de los parámetros a y c , de cada compuesto de serie de soluciones sólidas.

así con el valor de (300)

$$1/d^2 \approx 4/3 \{ (h^2/a^2) + 4/3 \{ 9/l^2 \} \}$$

entonces $a = \sqrt[3]{(12)d}$

y con el pico (208)

$$1/d^2 = 4/3 \left(4/a^2\right) + 64/c^2$$

$$\text{despejando } c, c = \sqrt{64(d^2 - 16a^2/3)} \quad c = \sqrt{64/(d^2 - 16a^2/3)}$$

Los valores de c y a en función de la concentración del ión huésped nos dan una idea de los cambios que puede sufrir una celda.

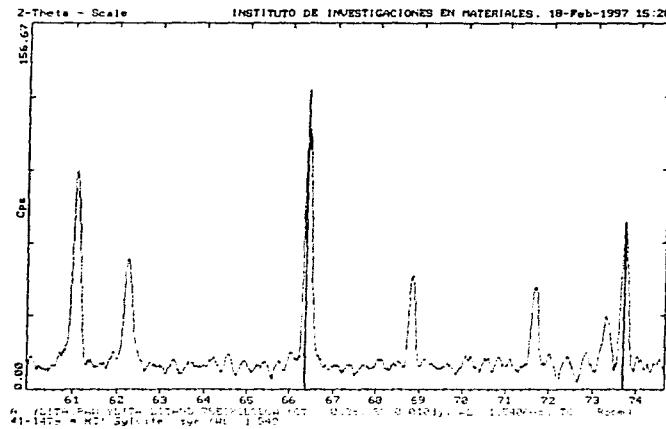


Figura # 5 Patrón de difracción de la mezcla mecánica de la solución sólida $\text{Li}_{0.925}\text{Ta}_{1.075}\text{Nd}_{0.05}\text{O}_3$ y KCl ; las líneas delgadas señalan los máximos de difracción del estandar interno

Determinación de las densidades experimentales de los compuestos de las series de soluciones sólidas.

En este trabajo los valores experimentales de las densidades se midieron en picnómetros marca Pyrex® de 10ml, con CCl_4 Reagent for spectrometry, como líquido de desplazamiento siguiendo los siguientes pasos:

Se pesó un picnómetro vacío (limpio y seco) y se anotó el peso. Una cantidad suficiente de muestra se pulverizó en un mortero de agata y se colocó en el picnómetro de manera que el polvo ocupó la mitad del picnómetro, se pesó este picnómetro con la muestra y se anotó el peso. Después se introdujo el CCl_4 hasta llenar el contenido del exterior y se colocó en un desecador conectado a una bomba de vacío, esto, con el fin de extraer el aire que estuviera atrapado en la superficie de las partículas de la muestra en polvo. Después se esperó a que el picnómetro equilibrara su temperatura con la temperatura ambiente, una vez equilibrada la temperatura del picnómetro, se llenó el picnómetro con el CCl_4 , cuidando que el líquido cubriera el canal del tapón, entonces se pesó rápidamente (dado que el CCl_4 se evapora más rápido se descartaron los pesos tomados cuando el líquido no cubría exactamente el río del canal, esto es, no sobrepasaba, ni formaba menisco) repitiendo varias veces, hasta obtener una colección de datos y sacar un peso promedio del peso del picnómetro con el sólido y el líquido que desplazó. Aparte se registró el peso del picnómetro pero conteniendo únicamente el CCl_4 . Los cálculos necesarios se efectúan empleando la siguiente ecuación:

$$\rho_{\text{experimental}} = \frac{(P_m + P_v)(P_l - P_m - P_v - P_{lm})}{\rho_{\text{CCl}_4} \cdot V}$$

Donde:

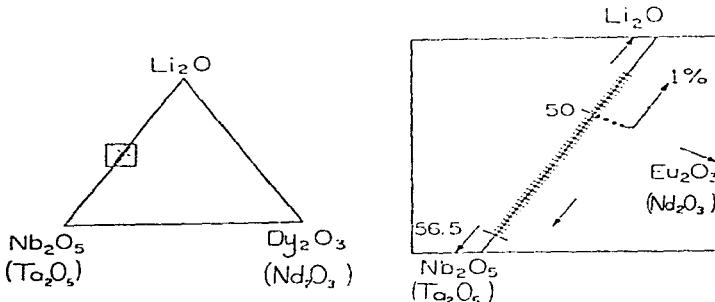
P_m = Masa del picnómetro con muestra

P_v = Masa de picnómetro vacío

P_l = Masa del picnómetro con líquido (CCl_4)

P_{lm} = Masa del picnómetro con líquido y muestra

ρ_{CCl_4} = Valor de la densidad del tetracloruro de carbono.

RESULTADOS.**Análisis cristaloquímico****Soluciones sólidas de LiNbO₃.****LiTaO₃ con Nd³⁺ y Dy³⁺ incorporados****a su red**El LiTaO₃ y LiNbO₃ forman con Dy₂O₃ y Nd₂O₃ soluciones sólidas en un intervalo muy limitado.En la figura 6, se muestran los diagramas de fases de las soluciones sólidas de LiTaO₃ y LiNbO₃ con Dy₂O₃ y Nd₂O₃, en donde los puntos marcados sobre la línea en la figura, representan las composiciones de los compuestos sintetizados.**Fig 6. Soluciones sólidas de los sistemas.**

La variación de los parámetros de red con la concentración de Dy₂O₃ y Nd₂O₃ en las series de soluciones sólidas se muestran en las siguientes tablas y gráficas:

PARÁMETROS DE CELDA a y c.

X	a	c	c/a
0.00	5.1494	13.862	2.6919
0.0025	5.1514	13.8474	2.688
0.005	5.1546	13.8601	2.6888
0.0075	5.1504	13.8539	2.6898
0.01*	5.153	13.8545	2.6886



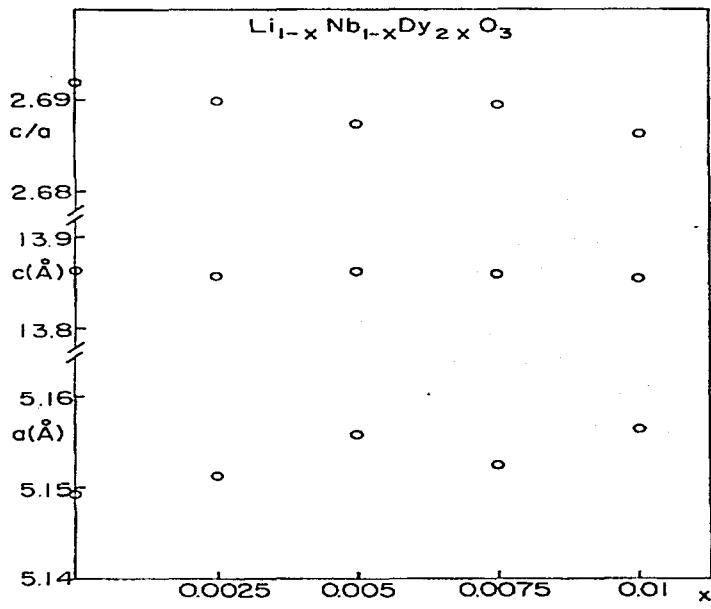
X	a	c	c/a
0.00	5.1494	13.862	2.6919
0.0025	5.1514	13.8571	2.6899
0.005	5.1559	13.8563	2.6874
0.0075	5.1525	13.8586	2.6896
0.01*	5.1565	13.8525	2.6864



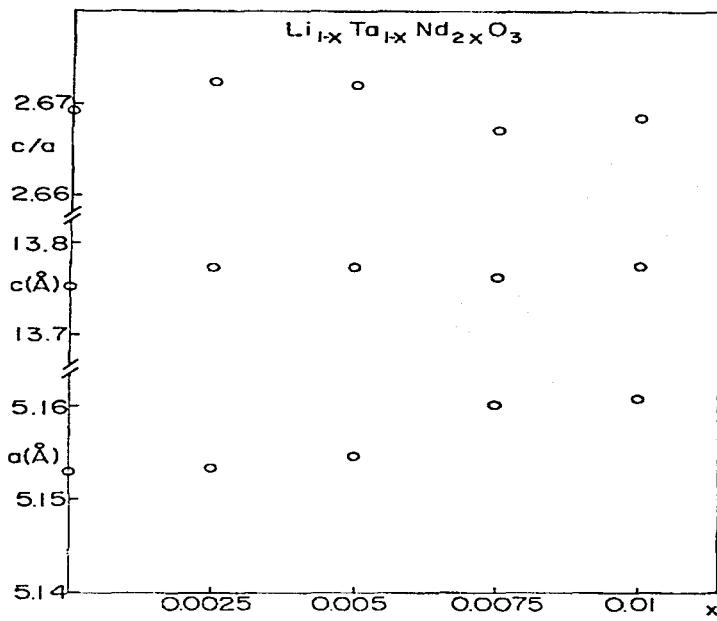
X	a	c	c/a
0.00	5.153	13.755	2.6693
0.0025	5.1535	13.7745	2.66728
0.005	5.1545	13.7745	2.6723
0.0075	5.1601	13.7656	2.6677
0.01*	5.1608	13.7725	2.6686

A_xLi_{1-x}Ta_{1-x}Dy_xO₃

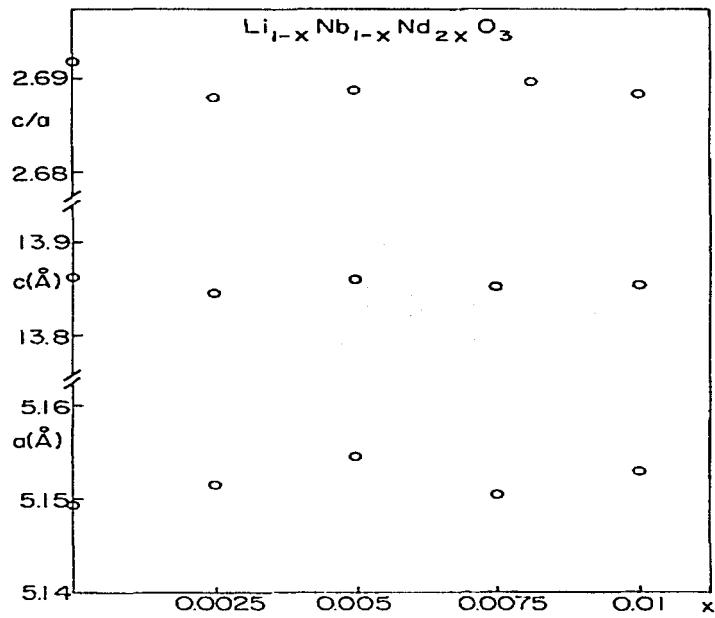
X	a	c	c/a
0.00	5.153	13.755	2.6693
0.0025	5.155	13.7656	2.6703
0.005	5.1570	13.7673	2.6696
0.0075	5.1635	13.7651	2.6658
0.01*	5.161	13.7673	2.6696



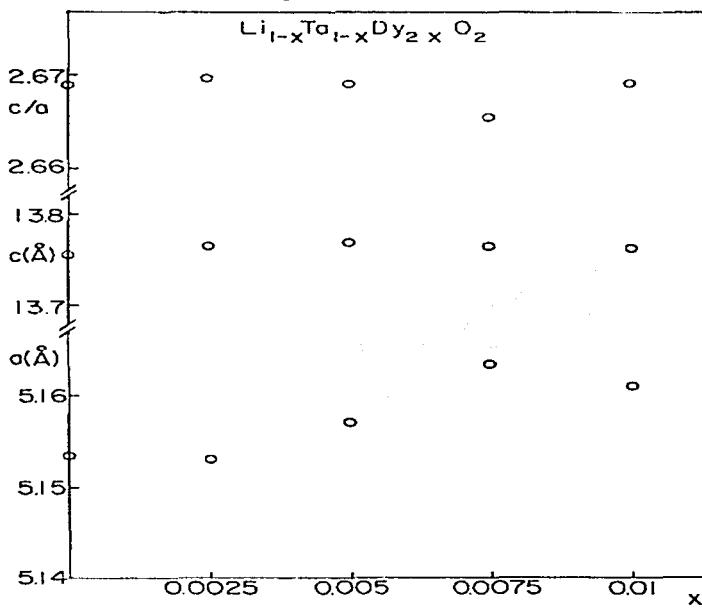
Gráfica #1. Variación de los parámetros de red a y c de las soluciones sólidas de $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Dy}_x\text{O}_3$ y de la relación c/a en función de X -mol de Dy_2O_3



Gráfica #2. Variación de los parámetros de red a y c de las soluciones sólidas de $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_x\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$ y de la relación c/a en función de X-mol de Nd_2O_3 .



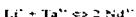
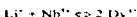
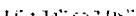
Gráfica #3. Variación de los parámetros de red a y c de las soluciones sólidas de $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$ y de la relación c/a en función de $X\text{-mol}$ de Nd_2O_3



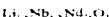
Gráfica #4. Variación de los parámetros de red a y c de las soluciones sólidas de $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Dy}_x\text{O}_2$ y de la relación c/a en función de X mol de Dy_2O_3 .

En las gráficas 1, 2, 3 y 4 el valor de el parámetro c permanece casi constante aunque el valor de a si varía, el cual aumenta con la concentración de Dy_2O_3 y Nd_2O_3 . La variación esperada en la relación c/a (tendencia a decrecer conforme a de Dy_2O_3 y Nd_2O_3 aumenta), es poco notable.

Aunque el intervalo de solubilidad encontrado para estas soluciones sólidas es muy limitado, se puede inferir que la dirección que sigue la región de solubilidad es hacia Dy_2O_3 (Nd_2O_3), esto implica un mecanismo de formación de las soluciones sólidas en el cual el número de cationes permanece constante, esto es, el mecanismo estoquiométrico de sustitución.



cuyas fórmulas son:



El límite de solubilidad obtenido experimentalmente es en todos los casos con $0 < X \leq 0.01$. El tiempo de reacción para las soluciones con Ta es menor, en contraste con con las soluciones sólidas que contienen Nb, por ejemplo, el tiempo de reacción para el compuesto $Li_{1-x}Ta_x(Nd_2O_3)$ con $X = 0.005$ fue de dos semanas en cambio para el compuesto $Li_{1-x}Nb_x(Nd_2O_3)$ también con $X = 0.005$ fue de 3 semanas.

Al exceder el límite de solubilidad de $X=0.01$ en el patrón de difracción de rayos-X, a veces, de encontrar las líneas que corresponden a una estructura tipo $LiNbO_3$ y/o $LiTaO_3$, aparecen líneas extra correspondientes a la coexistencia de una fase diferente correspondiendo a óxidos por ejemplo Nd_2TaO_5 o Dy_2TaO_5 , Dy_2O_3 , etc. En el anexo 1, se presentan los patrones de difracción de rayos-X de series de soluciones sólidas encontradas, en los cuales se nota un ligero desplazamiento de los máximos de difracción hacia valores menores de 20 conforme más óxido de tierra rara se incorpora a la red (observe a los cambios de d entre valores de 20 de 55 a 70 reportados en las tablas A-1-1 a la A-1-10), lo que indica un aumento en el volumen de la celda unitaria (vease el cambio en el volumen de la celda unitaria en el ejemplo realizado para las soluciones $Li_{1-x}Ta_x(Nd_2O_3)$ en la figura A-1-5 del anexo 1), esto se debe a que el volumen varía directamente con los parámetros de celda, los cuales son directamente proporcionales a d , que a su vez es inversamente proporcional a a .

En la figura 7, se observa un diagrama ternario con 4 líneas hipotéticas (se incluye el mecanismo anterior), cada una supone un mecanismo diferente de sustitución para las soluciones sólidas.

Mecanismo #1:

$\text{Li}^+ + \text{M}^{4+} \leftrightarrow 2 \text{Nd}^{3+}$ con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$

$\text{Li}^+ + \text{M}^{4+} \leftrightarrow 2 \text{Dy}^{3+}$ con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3$

Cuando $X = 1 \rightarrow \text{Dy}_2\text{O}_3, \text{Nd}_2\text{O}_3$

Mecanismo #2:

$4\text{Li}^+ + \text{M}^{4+} \leftrightarrow 5 \text{Nd}^{3+} + 2\text{V}$, con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$

$4\text{Li}^+ + \text{M}^{4+} \leftrightarrow 5 \text{Dy}^{3+} + 2\text{V}$ con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3$

cuando $X = 0.25 \rightarrow \text{Nb}_2\text{Nd}_2\text{O}_7, \text{Ta}_2\text{Nd}_2\text{O}_7$

Mecanismo #3:

$5\text{Li}^+ + 2\text{M}^{4+} \leftrightarrow 5 \text{Dy}^{3+} + 2\text{V}$, con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3$

$5\text{Li}^+ + 2\text{M}^{4+} \leftrightarrow 5 \text{Nd}^{3+} + 2\text{V}$, con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$

Cuando $X > 0.20 \rightarrow \text{Ta}_2\text{Nd}_2\text{O}_7, \text{Nb}_2\text{Nd}_2\text{O}_7$

Mecanismo #4:

$\text{Li}^+ + 4\text{M}^{4+} \leftrightarrow 7 \text{Dy}^{3+}$ con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3$

$\text{Li}^+ + 4\text{M}^{4+} \leftrightarrow 7 \text{Nd}^{3+}$ con $\text{M}^{4+} = \text{Nb}^{4+}, \text{Ta}^{4+}$; Fórmulas: $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3, \text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{1-x}\text{Nd}_{2x}\text{O}_3$

cuando $X < 0.25 \rightarrow \text{Li}_1\text{Nd}_2\text{O}_{12}, \text{Li}_1\text{Nb}_2\text{O}_{12}$

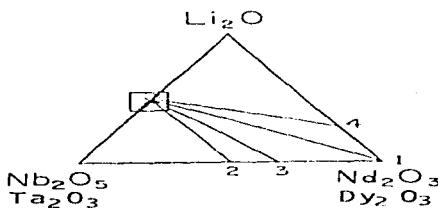


Figura #7 Diagrama de fases ternario para los mecanismos propuestos de formación de las soluciones sólidas de LiTaO_3 y LiNbO_3 , con Nd_2O_3 y Dy_2O_3 .

La medición de las variaciones de la densidad con la concentración de los cationes Nd³⁺ y Dy³⁺ se llevó acabo con el objeto de discernir entre los mecanismos de reacción propuestos.

Los errores experimentales involucrados en la determinación de la variación de los parámetros de red, *a* y *c*, con la concentración de cation de tierra rara que entraba a la red, *x*, son debido a errores involucrados en el montaje de la muestra en polvo en el portamuestras para la medición de el patrón de difracción en el equipo de rayos-X, esto provoca una discrepancia en los resultados que no permite apreciar un cambio lineal en la variación de el parámetro de red, el cual al ser muy pequeño (*c* < 0.01 Å), entra dentro de el límite de sensibilidad del equipo utilizado. Entonces dado que el cambio en los parámetros de red, *a* y *c* es pequeño, y para no introducir el error experimental mencionado, el cálculo de la densidad teórica para cada uno de los compuestos y las soluciones sólidas se hizo utilizando el volumen de celda de LiTaO₃ y LiNbO₃ como aproximación (ref. 22), y el peso molecular correspondiente para cada uno de los mecanismos de reacción propuestos usando la siguiente fórmula:

$$\rho = Z^*(P M / N_a) / \text{vol. celda}$$

Z = número de fórmulas unitarias (LiTaO₃ y LiNbO₃ = 6)

P.M. = peso molecular segun la fórmula propuesta por el mecanismo

N_a = número de Avogadro

Vol. celda = calculado con los parámetros de celda.

La siguiente tabla contiene las densidades obtenidas experimentalmente para todos los compuestos de las soluciones sólidas y se comparan con el valor teórico calculado para el mecanismo de reacción #1:

Li_{1-x} Nb_x Nd_{2x} O₆

X	peso molecular	densidad teórica g/ml	densidad experimental g/ml
0	147.85	4.6261	4.6261
.0025	148.3215	4.6109	4.64
.005	148.7931	4.6557	4.6497
.0075	149.2647	4.6704	4.6673
.01	149.7363	4.6852	4.6821

Resultados**Li_{1-x}Nb_xDy₂O₃**

X	peso molecular	densidad teórica	densidad experimental
0	147.85	4.6261	4.6261
.0025	148.4128	4.6438	4.6303
.005	148.9757	4.6614	4.65808
.0075	149.5386	4.679	4.6704
.01	150.1015	4.6964	4.6964

Li_{1-x}Ta_xNd₂O₃

X	peso molecular	densidad teórica	densidad experimental
0	235.88	7.457	7.457
.0025	236.13	7.4654	7.459
.005	236.383	7.4734	7.4635
.0075	236.6345	7.4813	7.4775
.01	236.886	7.4893	7.4841

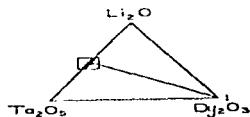
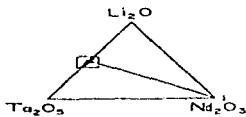
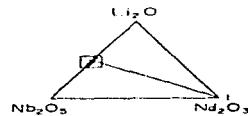
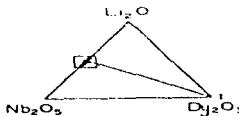
Li_{1-x}Ta_xDy₂O₃

X	peso molecular	densidad teórica	densidad experimental
0	235.88	7.4575	7.4575
.0025	236.22	7.4682	7.4654
.005	236.5656	7.4791	7.4727
.0075	236.9084	7.49	7.49
.01	237.2512	7.5008	7.5005

Para cada uno de los mecanismos esquematizados en los diagramas de fase, se puede ver que hay una variación en el contenido de Li, Ta, Nb, Nd, y Dy según la fórmula química para cada caso, por lo tanto la densidad en diferente.

Entonces, de las cuatro líneas hipotéticas que representan a cada uno de los mecanismos diferentes de sustitución de las soluciones sólidas de LiNbO_3 y LiTaO_3 , con Nd^{3+} y Dy^{3+} en los diagramas de fases ternarios, la línea correspondiente al mecanismo número 1 es el que concuerda con los resultados obtenidos para las densidades experimentales.

A continuación se presentan los diagramas de fases ternarios correspondientes a cada sistema en los que se marca ahora la linea estoquiométrica para cada sistema, propiciando así el mecanismo de sustitución de las soluciones sólidas de LiNbO_3 y LiTaO_3 , con Nd^{3+} y Dy^{3+} .



A continuación se presentan los valores de densidades teóricas calculadas también con el volumen de celda de LiTaO₃ y LiNbO₃ como aproximación, y el peso molecular correspondiente para cada uno de los mecanismos de reacción propuestos.

Mecanismo #1:



Fórmula:



X	peso molecular	densidad teórica g/ml
0	147.85	4.6261
.0025	148.3215	4.6499
.005	148.7931	4.6557
.0075	149.2647	4.6704
.01	149.7363	4.6852

Mecanismo #1



Fórmula:



X	peso molecular	densidad teórica
0	235.88	7.457
.0025	236.13	7.4654
.005	236.383	7.4734
.0075	236.6345	7.4813
.01	236.886	7.4893

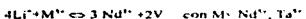
Mecanismo #1 $\text{Li}^+ + \text{M}^{3+} \leftrightarrow 2 \text{Dy}^{3+}$ con $\text{M}^{3+} = \text{Nb}^{3+}, \text{Ta}^{3+}$.

X	peso molecular	densidad teórica
0	147.85	4.6261
.0025	148.4128	4.6418
.005	148.9757	4.6614
.0075	149.5386	4.679
.01	150.1015	4.6964

Mecanismo #1 $\text{Li}^+ + \text{M}^{3+} \leftrightarrow 2 \text{Dy}^{3+}$ con $\text{M}^{3+} = \text{Nb}^{3+}, \text{Ta}^{3+}$ Fórmula: $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_{x}\text{Dy}_{2x}\text{O}_3$

X	peso molecular	densidad teórica
0	215.88	7.4575
.0025	236.22	7.4682
.005	236.5656	7.4791
.0075	236.9084	7.49
.01	237.2512	7.5008

Mecanismo #2.

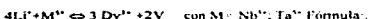


Fórmula:



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.45	7.4755
0.005	237.01	7.4932
0.0075	237.57	7.5109
0.01	238.1301	7.5286

Mecanismo #2.

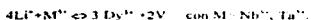


Formula:

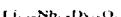


X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.5869	7.4798
0.005	237.2839	7.5018
0.0075	237.9809	7.5239
0.01	238.6779	7.5459

Mecanismo #2.



Fórmula:

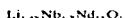


X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	148.6261	4.6515
0.005	149.4062	4.6759
0.0075	150.1864	4.7003
0.01	151.5153	4.7418

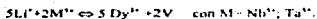
Mecanismo #2.



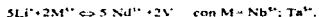
Fórmula:



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	148.6261	4.6515
0.005	149.4062	4.6759
0.0075	150.1864	4.7003
0.01	150.9665	4.7247

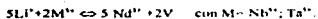
Mecanismo #3.**Fórmula:**

X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.9297	7.4906
0.005	237.9695	7.5235
0.0075	239.0092	7.5564
0.01	240.0490	7.5892

Mecanismo #3.**Fórmula:**

X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.7015	7.4834
0.005	237.5130	7.5091
0.0075	238.3245	7.5347
0.01	239.1360	7.5604

Mecanismo #3.



Fórmula:



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	149.0977	4.6662
0.005	150.3494	4.70544
0.0075	151.6011	4.74461
0.01	152.8528	4.7837

Mecanismo #3.



Fórmula:



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	149.3269	4.673411
0.005	150.8069	4.7197
0.0075	152.2868	4.7660
0.01	153.7668	4.8123

Mecanismo #4.**Fórmula**

X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.9069	7.4899
0.005	237.9238	7.5221
0.0075	238.9407	7.554
0.01	239.9576	7.5864

Mecanismo #4.**Fórmula**

X	Peso molecular	Densidad teórica
0	235.89	7.457
0.0025	236.6587	7.4798
0.005	237.2847	7.5018
0.0075	237.9820	7.5239
0.01	238.6794	7.5459

Mecanismo #4.



Fórmula



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	149.3727	4.6748
0.005	150.8984	4.72259
0.0075	152.4241	4.7703
0.01	153.9499	4.8180

Mecanismo #4

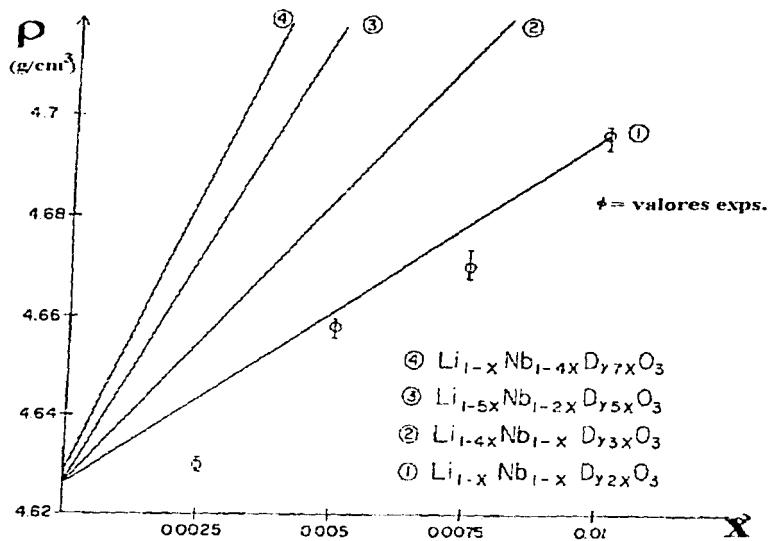


Fórmula



X	Peso molecular	Densidad teórica
0	147.84	4.627
0.0025	149.7413	4.6864
0.005	151.6416	4.7485
0.0075	153.5390	4.8052
0.01	155.4363	4.8646

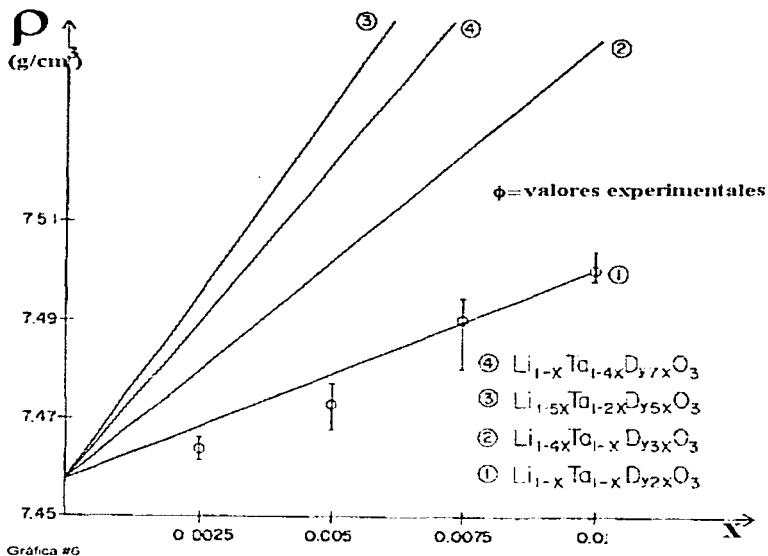
En las siguientes figuras se presenta la variación de la ρ con la composición X para cada uno de los mecanismos propuestos y numerados como en la figura 7, y se comparan con los valores de ρ encontrados experimentalmente.

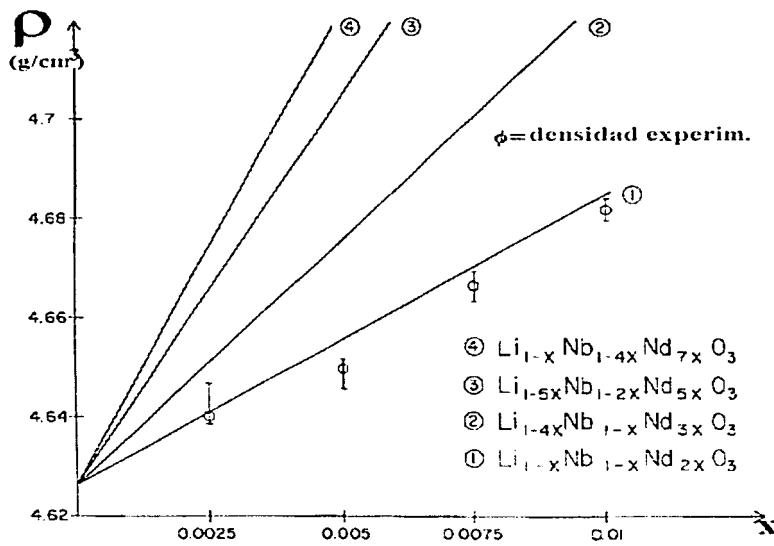


Gráfica #5:

ϕ = Valores de densidad experimental para los compuestos de las soluciones sólidas de Dy con LiNbO_3 , vs. x-mol de Dy.

Las rectas corresponden a la densidad teórica calculada para los mecanismos propuestos de formación de soluciones sólidas de LiNbO_3 , vs. x-mol de Dy.

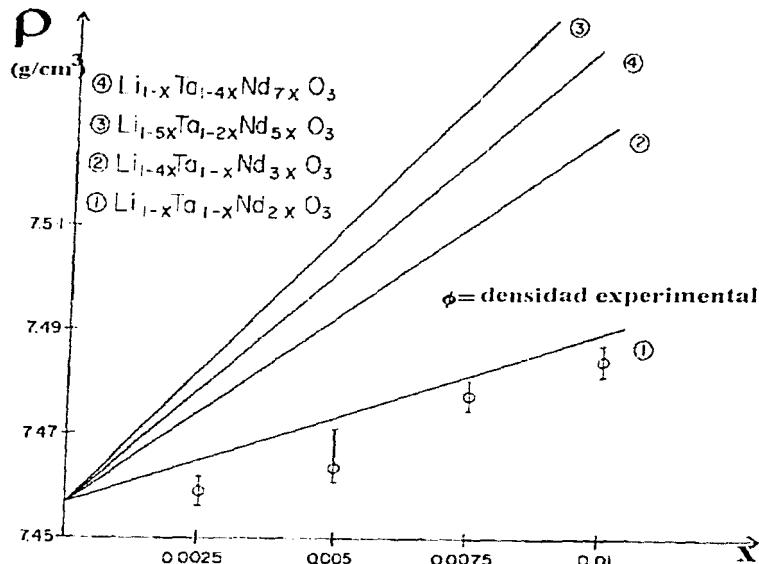




Gráfica #7

ϕ = Valores de densidad experimental para los compuestos de las soluciones sólidas de Nd con LiNbO_3 , vs x -mol de Nd

las rectas corresponden a la densidad teórica calculada para los mecanismos propuestos de formación de soluciones sólidas de LiNbO_3 vs x -mol de Nd

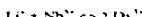
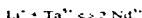
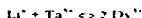


Gráfica #8

ϕ = Valores de densidad experimental para los compuestos de las soluciones sólidas de Dy con LiNbO_3 vs x -mol de Dy

Las rectas corresponden a la densidad teórica calculada para los mecanismos propuestos de formación de soluciones sólidas de LiNbO_3 vs x -mol de Dy

De las gráficas 5, 6, 7 y 8, se observa una congruencia entre los datos experimentales y los calculados para la densidad según el mecanismo:



en cada uno hay variación en el número total de cationes.

Discusión

- Se obtuvieron y caracterizaron cuatro series de soluciones sólidas de LiNbO_3 y LiTaO_3 , con dos cationes huesteped distintos de tierras raras; estas series se localizan en una línea estequiométrica $\text{LiNbO}_3\text{-LiTaO}_3$ y $\text{LiTaO}_3\text{-RE}_2\text{O}_5$ (RE = Nd y Dy) en el diagrama de fases ternario. Como era de esperarse, el intervalo de solubilidad obtenido para las soluciones sólidas trabajadas es limitado; esto se explica ya que los radios de los cationes Dy^{3+} y Nd^{3+} es mayor que el radio iónico de el Li^+ , Nb^{5+} y Ta^{5+} (radios iónicos efectivos: $\text{Li}^+ = 0.74$, $\text{Nb}^{5+} = 0.64$, $\text{Ta}^{5+} = 0.64$, $\text{Dy}^{3+} = 0.908$, y $\text{Nd}^{3+} = 0.981$ ref 20 y 21).
- Como se discutió anteriormente el sitio que ocupan los cationes que se introducen en una red cristalina (como la el LiTaO_3 , LiNbO_3), es muy importante para la comprensión de sus propiedades. Al establecer un mecanismo de reacción indirectamente se pueden conocer estos sitios. La medición de una propiedad física como la densidad (que se mide de una forma sencilla), conduce a determinar indirectamente este mecanismo. Por esta razón, se determinaron las densidades experimentales para cada uno de los compuestos que forman las series de soluciones sólidas.
- Se propuso el mecanismo de formación de las soluciones sólidas $\text{Li}^+ \cdot \text{M}^{5+} \leftrightarrow 2 \text{ RE}^{3+}$ con $\text{M}^{5+} = \text{Nb}^{5+}$, Ta^{5+}
- $\text{RE}^{3+}\text{-Nd}^{3+}$, Dy^{3+} , que se corroboró comparando los valores de densidad obtenidos experimentalmente y los correspondientes valores de densidad calculados a partir de la fórmula de el compuesto obtenida según el mecanismo el mecanismo.
- En un futuro se continuará con la medición de las propiedades físicas de los compuestos, como propiedades eléctricas y ópticas, para un desarrollo posterior de investigación de los compuestos situados fuera de la línea estequiométrica marcada en el diagrama de fases ternario, lo que da cabida además a un estudio de propiedades fisicoquímicas, que, una vez bien determinado será un aporte para los escasos estudios cristaloquímicos y de diagramas de fases completos.

5. El corrimiento encontrado de los máximos de difracción en los espectros de las soluciones sólidas hacia menor ángulo θ , con respecto a la posición que mantienen los máximos de el LiTaO₃ y el LiNbO₃, nos indica que hay un aumento en el volumen de la celda unitaria hexagonal de LiTaO₃ y el LiNbO₃.

En el anexo 2 se presenta la tabla de tratamientos térmicos de los compuestos obtenidos.

Conclusiones.

Se encontraron los intervalos de solubilidad para las soluciones sólidas formadas con el LiTaO₃ y LiNbO₃ con Nd₂O₃ y Dy₂O₃.

Se determinaron los parámetros de red a y c para cada uno de los compuestos que forman las series de soluciones sólidas y sus densidades.

Se propuso un mecanismo de reacción para la formación de estas soluciones sólidas.

BIBLIOGRAFÍA.

1. FERNANDO ARGÜELLO LOPEZ.

JOSE MANUEL CABRERA

Electrooptics phenomena, materials and appl

Academic Press, 1994

2. B ELLOUADI, M ZRIOUIL, et al.

Ferroelectrics, 1981, Vol. 38, 739-796

3. R.R. SHURGAONKAR, J.C. LIM, E.J. STAPLES.

Ferroelectrics, 1, 27, 63, 1980

4. J RAVEZ

Mat. Res. Bull., 15, 483-487, 1980

5. B ELLOUADI, M ZRIOUIL, J. RAVEZ AND P. HAGENMÜLLER

Mat. Res. Bull., vol. 16, 1099-1106, 1981

6. H.P. REHRMAN

Infr. Phys., 15, 225, 1975

7. A.M. GLASS

J. Appl. Phys., 40, 4694, 1969

8. K.K. DUB

J. Mat. Res., 2(5), set oct, 1987

9. S.C. ABRAHAMS, and J.L. BERNSTEIN

J. Phys. Chem. Solids, 28,1685, (1967).

10. P GUNTER.

Phys. Rev. Rep., 93,199, 1982

11. B. GUENAINS, M. BAUDU, M. MINIER,

Mat. Res. Bull., vol 16, 643-655, 1981

12. A. GARCIA CABANES, J.A. SANZ-GARCIA, J.M. CABRERA.

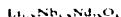
- Phys. Review B, 37, Num 11, 1988
13. P.K. GALLAGHER, H.M. O'BRIAN JR
J. Am. Ceram. Soc., 68, 147, 1985
14. D.M. KROL, G. BLASER, R.C. POWELL,
J. Chem. Phys., 73, 163, 1980
15. L.V. KOVACS, V. SZALAY, R. CAPELETTI
Solid State Commun., 52, 1029, 1984
16. M.J. DE ROSENDO, I. ARIZMENDI, J.M. CABRERA and F. AGULLÓ LOPEZ.
Solid State Commun., 59, 499, 1986
17. R.C. ROOP
Studies in inorganic chemistry 12
Luminescence and the solid state
Elsevier
Amsterdam-Oxford-N.Y. 1991
18. ANTHONY R. WEST
Solid state chemistry and its application
John Wiley and Sons
Chichester, N.Y., Brisbane, Toronto, Singapore
1984
19. A.K. CHILTHAM and P. DAY
Solid State Chemistry
Techniques
Oxford Science Publications
1987
20. R.D. SHANNON and C.T. PREWITT
Acta Cryst. B25, 925, 1969
21. R.D. SHANNON and C.T. PREWITT
Acta Cryst. B26, 1046, 1970
22. MARÍA VILLAFUERTE
Tesis doctoral
Universidad Autónoma Metropolitana
unidad Iztapalapa
Septiembre de 1991

Anexo 1 (Spectros de difraccion y sus tablas)

Anexo 1

Los patrones de difraccion de las soluciones sldas se agrupan por serie, para mayor claridad los valores de d no se presentan sobre cada mximo (como en la figura #1), si no que se reportan en las tablas señaladas.

Spectros de difraccion de rayos-X de la figura A1-1



X	espectro de	Número (orden de arriba hacia abajo)
0	LiNbO_3	1 (tinta negra)
.0025	$\text{Li}_{0.975}\text{Nb}_{0.025}\text{Nd}_{1.975}\text{O}_3$	2 (tinta verde)
.005	$\text{Li}_{0.95}\text{Nb}_{0.05}\text{Nd}_{1.95}\text{O}_3$	no disponible
.0075	$\text{Li}_{0.925}\text{Nb}_{0.075}\text{Nd}_{1.925}\text{O}_3$	3 (tinta azul)
.01	$\text{Li}_{0.9}\text{Nb}_{0.1}\text{Nd}_{1.9}\text{O}_3$	4 (tinta prpura)

espectro de

Valores de d, 2θ,etc.



tabla A-E1



tabla A-E2

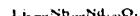


tabla AE-3



tabla AE-4



Anexo I (Spectro de difraccion y sus tablas)

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 12:02:49

Dump of file: C:\USERDATA\YLIBN.DIF (05-May-1997 12:02:18)
 Sample name: YLIBN LINBO3 SOLO (29-Jan-1997 19:42:48)
 DSMEAS - Program:PAUSTIN.DPL

Wavelength 1: 1.54056
 Wavelength 2: 1.54439

Range #	1	Row data measured from 2 theta =	2.000 to 110.000		
Step size:	0.006	Time/step :	3.0		
Peak Width:	1.241	Threshold :	2.3		
-N-	2	Theta	---d---	---CPS---	---%
1	23.696	3.7516	1872.59	100.00	
2	32.705	2.7359	663.26	35.53	
3	34.806	2.5754	401.82	21.46	
4	39.000	2.3075	95.32	5.09	
5	40.955	2.2492	240.11	12.82	
6	42.558	2.1225	222.71	11.89	
7	46.539	1.8740	462.33	24.69	
8	51.267	1.7183	492.11	26.28	
9	56.147	1.6168	326.32	17.53	
10	57.007	1.6141	159.81	8.53	
11	61.097	1.5155	209.53	15.30	
12	62.416	1.4860	252.06	13.46	
13	68.576	1.3673	104.07	5.56	
14	72.245	1.3225	85.44	4.56	
15	73.557	1.2865	56.29	3.01	
16	76.077	1.2501	77.49	4.14	
17	79.520	1.2172	126.58	6.76	
18	79.240	1.2079	102.88	6.36	
19	81.603	1.1764	65.83	3.92	
20	82.800	1.1648	90.87	4.85	
21	85.511	1.1241	99.60	4.84	
22	86.846	1.1005	57.77	3.09	
23	92.086	1.0591	70.13	3.75	
24	91.957	2.0536	91.62	1.89	
25	99.160	1.0116	54.66	2.92	
26	99.919	1.0061	83.67	4.27	
27	103.513	0.5568	92.88	4.96	
28	104.702	0.9729	69.52	3.71	
29	105.763	0.9660	45.57	2.43	

Tabla A-E1 Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción del espectro de rayos-X de LiNbO₃ (inta negra). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-MAY-1997 12:06:24

Dump of file: C:\USERDATA\YNNB25.DIF (05-May-1997 12:06:10)
 Sample name : YNNB25 LINBND25E6 (01-Nov-1996 08:11:56)
 DSMEAS - Program:MARTIN.DOL

Wavelength 1: 1.54060
 Wavelength 2: 1.54430

Range # 1
 Rwp data measured from 2 theta = 2.000 to 110.000
 Step size: 0.010 Time/step: 5.0
 Peak width: 0.378 Threshhold: 1.8

-N-	2 theta	d	CPS	%
1	23.698	3.7514	692.31	100.00
2	32.700	2.7163	215.21	31.06
3	34.795	2.5762	141.73	20.47
4	38.978	2.3089	49.34	7.21
5	40.061	2.2489	98.56	14.25
6	42.539	2.1235	134.74	19.46
7	48.499	1.8755	190.00	27.44
8	53.227	1.7195	234.82	33.92
9	56.087	1.6384	133.27	19.26
10	57.002	1.6143	53.92	7.79
11	61.072	1.5161	150.92	21.80
12	62.390	1.4872	52.04	7.00
13	68.533	1.3581	20.74	3.00
14	71.246	1.3010	16.26	2.35
15	73.460	1.2680	18.13	2.66
16	75.700	1.2505	32.87	4.88
17	78.452	1.2181	61.18	8.84
18	79.226	1.2081	49.43	7.14
19	81.760	1.1770	32.66	4.72
20	82.761	1.1653	31.16	4.50
21	83.701	1.1545	12.18	1.76
22	86.440	1.1244	29.99	3.03
23	88.752	1.1013	15.36	2.22
24	92.037	1.0703	17.24	2.49
25	93.023	1.0617	18.18	2.63
26	93.953	1.0537	22.56	3.26
27	99.385	1.0125	18.14	2.62
28	99.821	1.0069	16.06	2.43
29	103.388	0.9816	21.47	3.10
30	104.588	0.9730	18.96	2.74

Tabla A-E2. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de Li...Nb...Nd...O_x (tinta verde). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. Tambien se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

DIPFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 12:56:40
 Dump of file: C:\USERDATA\YNHND75.DIF (05-May-1997 12:59:26)
 Sample name: YNHND75.L1.RAND75HS.ELOW (03-Dec-1996 00:42:14)
 DSNEAS - Program:MARTIN.DCL

Wavelength 1: 1.51059
 Wavelength 2: 1.54459

Range #	1	Raw data measured from 2 theta =	2.000 to 120.000	
Step size :	0.040	Time/step :	8.0	
Peak width:	1.330	Threshold :	2.5	
-N	2 theta	---d----	---Cps----	----
1	23.702	3.7508	2060.15	100.00
2	32.698	2.7164	170.82	18.00
3	34.837	2.5712	247.49	12.01
4	39.000	2.3076	431.08	2.09
5	40.000	2.2405	151.17	6.51
6	42.664	2.1030	318.27	18.13
7	48.515	1.8739	424.01	20.58
8	53.245	1.7182	267.35	12.49
9	56.096	1.6362	181.87	8.83
10	57.005	1.6141	104.04	5.09
11	57.005	1.5911	196.40	11.27
12	62.395	1.3671	56.31	2.60
13	68.551	1.3674	65.66	3.13
14	71.211	1.3230	69.35	3.22
15	73.402	1.2877	50.45	2.45
16	76.076	1.2501	79.75	3.95
17	76.076	1.2474	61.61	4.45
18	79.202	1.2074	38.67	1.86
19	81.800	1.1705	28.80	1.40
20	82.793	1.1649	65.69	3.19
21	86.452	1.1247	26.19	1.20
22	88.197	1.1059	62.65	3.06
23	93.006	1.0534	69.56	3.36
24	93.006	1.0533	26.31	1.20
25	99.108	1.0122	37.17	1.80
26	99.900	1.0063	52.76	2.56
27	103.413	0.9812	44.06	2.14
28	106.810	0.9733	14.71	0.72
29	109.510	0.9644	49.71	2.22
30	113.808	0.9232	36.32	1.76
31	115.323	0.9117	18.76	0.91
32	116.806	0.9041	60.43	2.94

Tabla A-E3. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de $\text{Li}_{0.8}(\text{NH}_4)_2\text{Ni}_{0.6}\text{O}_3$ (tinta purpura). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 12:58:30

Dump of file: C:\USERS\BATA\YOUNGDIS.DIF (05-May-1997 12:09:46)
 Sample name: YOUNGDIS LINHNDIS DENTO (01-Dic-1996 22:19:08)
 DSHDAD = Program\PRINTDIF.QCL

Wavelength 1: 1.54056

Wavelength 2: 1.54439

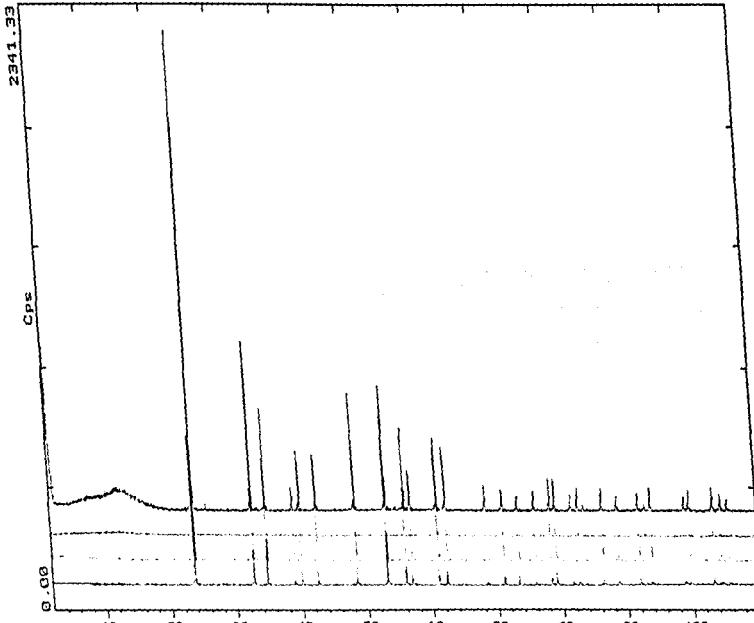
Range #	1	Raw data measured from 2 theta =	2.000 to 120.000
Step size:	0.040	Time/step :	6.0
Pow width:	1.000	Threshold :	2.3
-W#	2_theta	--d----	--Cpm--
1	23.710	3.7405	619.00
2	32.694	2.7361	130.48
3	34.801	2.5759	172.35
4	38.968	2.3024	21.05
5	40.062	2.2498	47.54
6	42.552	2.1228	56.36
7	48.522	1.8747	67.12
8	50.500	1.8174	181.30
9	56.047	1.6395	80.48
10	58.953	1.6755	34.16
11	61.063	1.5163	62.69
12	62.390	1.4072	52.28
13	68.566	1.3676	17.60
14	71.195	1.3233	44.37
15	73.478	1.2877	32.80
16	76.033	1.2507	16.11
17	79.468	1.2248	50.49
18	79.199	1.2043	50.58
19	81.739	1.1772	16.02
20	82.692	1.1660	27.63
21	86.439	1.1243	17.05
22	88.760	1.1013	20.72
23	91.964	1.0711	26.37
24	93.901	1.0541	11.08
25	99.003	1.0130	20.35
26	99.295	2.0070	11.61
27	103.371	0.9821	36.20
28	107.434	0.9541	15.62
29	113.070	0.8733	15.79
30	115.213	0.9122	8.11
31	116.265	0.8974	20.64

Tabla A-E4. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS

D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de $\text{Li}_{0.8}\text{Nb}_2\text{O}_5$ (fita morada). CPM= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. Tambien se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barido.

2-Theta - Scale

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES, 08-Apr-1997 17:28



ACRYLICRIPAN FILLEN LIMERO3 SOLU. CHT 3.0g, SS 0.040M, NL 1.54054g, TG = Room

ACRYLICRIPAN FILLEN LIMERO3 LENTO CHT 3.0g, SS 0.040M, NL 1.54066g, TG = Room

Anexo 1.

Fig. A-E1.

Especro de difracci^{on}n de la serie de

soluciones s^{olidas} de LiMnO₃ con Nd₂O₃.

Ver tambi^{en} las tablas A-E1, A-E2, A-E3
y A-E4.

Anexo I

Espectros de difracción de rayos-X de la figura A-E2.



X	espectro de	Número (orden de arriba hacia abajo)
0	LiTaO_3	1 (tinta negra)
.0025	$\text{Li}_{0.975}\text{Ta}_{0.025}\text{Dy}_{0.001}\text{O}_3$	2 (tinta verde)
.005	$\text{Li}_{0.95}\text{Ta}_{0.05}\text{Dy}_{0.005}\text{O}_3$	3 (tinta azul)
.0075	$\text{Li}_{0.925}\text{Ta}_{0.075}\text{Dy}_{0.001}\text{O}_3$	4 (tinta purpura)
.01	$\text{Li}_{0.9}\text{Ta}_{0.1}\text{Dy}_{0.01}\text{O}_3$	5 (tinta morada)

espectro de

Valores de d, 2θ, etc



tabla A-E6



tabla A-E7



tabla A-E8

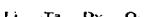


tabla A-E9



Tabla -E10

DIFFRAC / AT -- PRINTEDIF V1.0 *** ON-May-1997 13:01:38

Dump of file: GRANULATEDATAFILE.DIF (ON-MAY-1997 12:11:44)
 Sample name : YEL L10AO1 SLOW 129.03-1995 07:30:50
 DGMHAS = Program:MAINTAIN.DQH

Wavelength 1: 1.54000
 Wavelength 2: 1.54430

Range	#	1	Raw data measured from 2 theta =	2.000 to 120.000
Stop size	t	0.010	Time/step	4.0
Peak width	w	0.320	Threshold	1.0
-N=	2	theta	--d--	--CPS--
1	22.787	3.2776	179.65	100.00
2	32.862	2.7233	550.01	100.91
3	34.839	2.5711	346.78	10.49
4	39.251	2.2934	64.73	3.64
5	40.121	2.2446	36.00	2.02
6	42.602	2.1205	154.16	8.06
7	48.653	1.1000	202.06	14.66
8	50.500	1.7138	120.01	100.91
9	56.150	1.6167	550.21	10.49
10	57.339	1.6556	81.50	4.10
11	61.108	1.5135	126.16	7.00
12	62.426	1.4964	76.35	4.10
13	68.861	1.3024	59.46	3.24
14	72.840	1.2600	39.06	2.05
15	73.200	1.2471	34.90	1.96
16	76.254	1.1276	50.71	2.85
17	79.503	1.2175	96.81	3.19
18	79.521	1.1044	46.24	2.60
19	82.219	1.1716	10.81	1.11
20	82.453	1.1661	38.86	2.14
21	84.676	1.1747	15.99	0.82
22	86.631	1.1259	37.36	2.10
23	88.826	1.1007	18.41	1.03
24	92.478	1.0666	34.14	1.92
25	93.119	1.0609	12.96	0.73
26	94.593	1.0483	27.52	1.55
27	99.104	1.0192	20.61	1.05
28	101.223	1.0146	21.72	1.40
29	101.403	0.0110	22.11	1.47
30	104.631	0.9734	26.01	1.51
31	106.609	0.9607	16.37	0.86
32	110.772	0.9160	14.20	1.00
33	112.632	0.9204	25.33	1.48
34	112.945	0.9186	24.53	1.48
35	117.705	0.0001	1.02	0.03
36	118.522	0.8052	30.72	2.06

Tabla A-66. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de L10AO1 (tinta negra). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:03:00

Dump of file: C:\USERDATA\YTADY25.DIF (05-May-1997 12:12:24)
 Sample name : YTADY25_LITADYO25RG (12-Nov-1996 06:21:24)
 DSMRAS - Program:MAINTIN.DOL

Wavelength 1: 1.54056
 Wavelength 2: 1.54439

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 110.000
 Step size : 0.020 Time/step : 8.0
 Peak Width: 0.322 Threshold : 2.4

-N-	2 theta	d	Cpm	A
1	23.760	3.7416	1496.34	100.00
2	32.840	2.7250	620.00	41.43
3	34.827	2.5734	359.42	24.02
4	39.238	2.2941	95.09	6.36
5	40.124	2.2455	50.75	3.39
6	42.570	2.1215	201.52	13.67
7	46.614	1.8713	271.18	18.12
8	53.456	1.7127	352.66	23.57
9	56.123	1.6374	198.80	13.29
10	57.335	1.6057	124.21	8.30
11	61.165	1.5140	186.02	11.09
12	62.410	1.4867	99.00	6.52
13	58.847	1.3626	71.05	4.75
24	71.559	1.3159	63.15	4.22
15	74.120	1.2824	56.14	3.95
16	76.248	1.2477	56.36	3.77
17	78.498	1.2176	61.74	4.33
18	79.512	1.2045	71.89	4.80
19	82.199	1.1718	33.69	2.55
20	82.650	1.1642	47.81	3.19
21	84.331	1.1475	26.17	1.98
22	86.631	1.1228	54.53	4.64
23	88.828	1.1008	22.10	1.48
24	92.469	1.0666	47.15	3.15
25	93.105	1.0610	19.90	1.33
26	94.589	1.0482	39.87	2.67
27	99.110	1.0122	27.01	1.81
28	100.126	1.0046	31.38	2.16
29	103.487	0.9809	35.79	2.39
30	104.630	0.9733	24.47	1.64
31	106.605	0.9607	22.51	1.50

Tabla A-E7. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción del espectro de rayos-X de Li₂Si₃N₄O₄(D₁), (tinta verde). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V2.G *** 05-May-1997 13:03:16

Dump of file: C:\USERDATA\YILLYS.DIF (05-MAY-1997 12:12:56)
 Sample name : YILLYS.LITAOYOSERGION (16-Nov-1996 09:33:38)
 DIFFRAC - Program: MARTIN.ICL

Wavelength 1: 1.54056
 Wavelength 2: 1.54139

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 1.000 to 110.000
 Step size : 0.020 Time/step : 8.0
 Peak width: 0.122 Threshold : 2.4

-N-	2 theta	d	Cps	%
1	23.787	3.7376	844.06	100.00
2	32.882	2.7216	307.61	36.44
3	34.842	2.5728	185.71	22.00
4	39.306	2.3903	33.27	3.94
5	40.156	2.2439	21.31	2.53
6	42.598	2.1207	96.30	11.42
7	46.632	1.8706	116.43	13.79
8	53.155	1.7126	155.57	18.63
9	56.096	1.6041	91.66	10.86
10	56.390	1.5935	55.87	6.52
11	61.155	1.5142	73.31	8.60
12	62.381	1.4874	47.92	5.68
13	68.876	1.3621	25.77	3.05
14	71.713	1.3147	25.53	3.02
15	73.421	1.2886	19.46	2.31
16	76.222	1.2480	25.45	2.90
17	78.429	1.2184	28.31	3.35
18	79.507	1.2045	30.39	3.60
19	82.245	1.1713	18.27	2.16
20	82.799	1.1548	20.12	2.38
21	86.567	1.1235	24.24	2.87
22	88.733	1.1016	12.27	1.46
23	92.470	1.0666	20.14	2.39
24	93.027	1.0617	9.46	1.12
25	94.610	1.0480	17.54	2.08
26	98.997	1.0130	12.73	1.51
27	100.066	1.0051	13.17	1.56
28	101.365	0.9818	16.22	2.16
29	104.504	0.9742	13.40	1.59

Tabla A-EB. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS DS500) de d (distancia interplanar) y de % para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de $\text{La}_{1-x}\text{Ta}_x\text{O}_3$ (tinta azul). CPS es intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:03:30

Dump of file: C:\USERS\DATA\YTADY75.DIF (05-MAY-1997 12:14:00)
 Sample name: YTADY75 LITADY075CISLOW (13-NOV-1996 06:39:24)
 DSMEAS - Program: MARTIN.DCL

Wavelength 1: 1.54056
 Wavelength 2: 1.54439

Range #	1	Raw data measured from 2 theta =	2.000 to 110.000
Step size	0.020	Time/step:	8.0
Peak width:	0.322	Threshold:	2.4
-M- 2 theta ---d---		--CPS--	--%
1 23.748	3.7415	1108.33	100.00
2 32.868	2.7227	319.20	28.81
3 34.779	2.5773	185.21	16.71
4 39.292	2.2911	34.15	3.10
5 40.076	2.2479	22.00	2.06
6 42.340	2.1234	88.67	8.00
7 48.557	1.8734	137.14	12.37
8 53.520	1.7177	184.04	17.00
9 55.076	1.6400	81.25	7.33
10 57.379	1.6045	55.72	4.98
11 61.008	1.5157	64.79	5.85
12 62.281	1.4895	40.13	3.62
13 68.840	1.3627	27.55	2.49
14 71.725	1.3148	23.45	2.12
15 73.335	1.2829	15.34	1.38
16 75.145	1.2491	26.13	2.36
17 78.323	1.2197	21.84	1.97
18 79.470	1.2050	30.39	2.74
19 82.216	2.1715	12.09	1.18
20 87.142	1.1400	12.07	1.10
21 86.475	1.1245	20.03	1.81
22 88.612	1.1028	12.15	1.10
23 92.420	1.0670	17.78	1.60
24 94.626	1.0479	15.78	1.43
25 98.652	1.0141	9.95	0.90
26 99.980	1.0057	13.80	1.25
27 103.225	0.9827	12.33	1.11
28 104.305	0.9755	10.23	0.92
29 106.694	0.9601	7.66	0.69

Tabla A-E9. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 20 para cada máximo de difracción del espectro de rayos-X de Li₂Si₃Ta₂O₁₀ (lila púrpura), CPS: intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el berrido.

Anexo I (Espectros de difracción y sus tablas)

```

    10   87.730  1.1714      342.77     3.15
  DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 09-May-1997 13:03:48
 Dump of file: C:\URHRHDATA\YLTDY18.DIF (05-May-1997 12:15:08)
 Sample name: YLTDY18.LTADYOISSLOW (08-Dec-1996 04:56:20)
 DIFNEAR - Program:MAINTIN.DGL

 Wavelength 1: 1.34056
 Wavelength 2: 1.34439

 Range # 1
 Raw data measured from 2 theta -
 Step size:  0.040 Time/stop:  20.0
 Peak width:  0.546 Threshold:  2.8

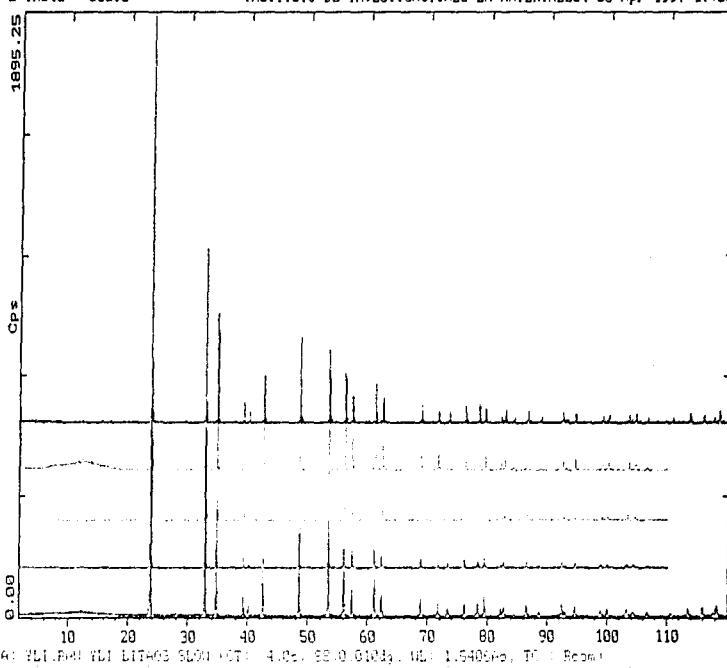
 -N- 2 theta---d--- CPS--- %---
 1  23.778  3.7309  1473.13  100.00
 2  32.100  2.7233  590.60  40.00
 3  38.800  2.4110  30.12  20.00
 4  49.104  2.2904  63.18  4.29
 5  40.076  2.2481  35.07  2.38
 6  42.566  2.1221  148.67  10.09
 7  48.560  1.7120  207.18  14.06
 8  52.560  1.6130  50.00  20.80
 9  56.055  1.6193  142.78  5.89
 10  57.360  1.6046  65.69  5.82
 11  61.076  1.5160  119.71  8.13
 12  66.240  1.4195  60.27  4.10
 13  68.778  1.3624  60.01  4.07
 14  71.746  1.3145  46.20  3.14
 15  73.330  1.2900  27.51  1.87
 16  76.150  1.2491  41.43  2.81
 17  76.150  1.2193  40.62  2.76
 18  79.340  1.1711  57.56  3.93
 19  82.217  1.1713  22.90  1.62
 20  82.681  1.1661  32.19  2.18
 21  84.423  1.1463  12.17  0.83
 22  86.522  1.1250  34.85  2.37
 23  86.524  1.1229  16.00  1.00
 24  92.447  1.0668  38.26  2.60
 25  92.931  1.0625  14.82  1.01
 26  94.630  1.0479  32.25  2.19
 27  94.631  1.0441  18.30  1.24
 28  100.060  1.0025  23.27  1.58
 29  103.263  0.9725  23.27  1.58
 30  104.315  0.9753  17.70  1.21
 31  106.715  0.9600  14.31  0.97
 32  110.550  0.9360  12.92  0.88
 33  111.519  0.9300  25.00  1.33
 34  115.501  0.9088  28.68  1.93
 35  117.768  0.8997  13.66  0.93
 36  110.229  0.8976  33.89  2.30

```

Tabla A-E10. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y d_{20} para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de $\text{Li}_{0.7}\text{Ta}_{0.3}\text{Dy}_{0.2}\text{O}_3$ (linta morada). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

2-Theta - Scale

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES. 08-Apr-1997 17:38



40 PLT, RHE YLI LiTaO₃ 95.00% + CT 4.00, SS 0.0103, UL 1.540640, TC Room

40 PLT, RHE YLI LiTaO₃ 95.00% + CT 30.00, SS 0.049147, UL 1.540640, TC Room
40 PLT, RHE YLI LiTaO₃ 95.00% + CT 30.00, SS 0.049147, UL 1.540640, TC Room

Anexo 2.

Fig. A-E2

Especetros de difraccion de rayos-X de las soluciones solidas de LiTaO₃ con Dy₂O₃.

Ver tambien las Tablas A-E6, A-E7, A-E8,
A-E9 y A-E10

Anexos

Espectros de difracción de rayos-X de la figura A-E3.

$\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_{x/2}(\text{Dy}_{x/4})_2\text{O}_3$

X	espectro de	Número (orden de arriba hacia abajo)
0	LiNbO_3	1 (tinta negra)
.0025	$\text{Li}_{0.995}\text{Nb}_{0.005}(\text{Dy}_{0.005})_2\text{O}_3$	2 (tinta verde)
.005	$\text{Li}_{0.99}\text{Nb}_{0.01}(\text{Dy}_{0.01})_2\text{O}_3$	3 (tinta azul)
.0075	$\text{Li}_{0.985}\text{Nb}_{0.015}(\text{Dy}_{0.015})_2\text{O}_3$	4 (tinta púrpura)
.01	$\text{Li}_{0.98}\text{Nb}_{0.02}(\text{Dy}_{0.02})_2\text{O}_3$	5 (tinta morada)

espectro de

Valores de d, 2θ, etc.

LiNbO_3	tabla A-E1
$\text{Li}_{0.995}\text{Nb}_{0.005}(\text{Dy}_{0.005})_2\text{O}_3$	tabla A-E11
$\text{Li}_{0.99}\text{Nb}_{0.01}(\text{Dy}_{0.01})_2\text{O}_3$	tabla A-E12
$\text{Li}_{0.985}\text{Nb}_{0.015}(\text{Dy}_{0.015})_2\text{O}_3$	tabla A-E13
$\text{Li}_{0.98}\text{Nb}_{0.02}(\text{Dy}_{0.02})_2\text{O}_3$	tabla A-E14

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:08:00

Dump of file: C:\USERDATA\YHNDY25.DIF (05 May 1997 12:16:36)
 Sample name : YHNDY25 LINBDYCORRECTION (05-Dec-1996 00:42:42)
 D5MPAS = Program:MARTIN.DCL

Wavelength 1: 1.54056
 Wavelength 2: 1.54439

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 120.000
 Step size : 0.040 Time/step : 8.0
 Peak width : 0.545 Threshold : 2.8

-N-	2 theta	Cps
1	21.763	3.7410
2	32.757	2.7317
3	34.836	2.5733
4	39.024	2.3062
5	40.100	2.4568
6	42.571	2.1500
7	48.594	1.9731
8	53.259	1.7102
9	56.123	1.5374
10	57.003	1.6122
11	61.144	1.5149
12	62.396	1.4970
13	68.368	1.3673
14	71.245	1.3225
15	73.479	1.2077
16	76.104	1.2467
17	78.491	1.2172
18	79.129	1.2079
19	81.768	1.1764
20	82.759	1.1651
21	83.700	1.1543
22	86.466	1.1249
23	83.805	1.1069
24	92.062	1.0762
25	93.010	1.0512
26	99.084	1.0121
27	99.058	1.0056
28	102.443	0.9817
29	102.634	0.9723
30	105.792	0.9658
31	106.171	0.9529
32	113.171	0.9222
33	115.301	0.9118
34	116.756	0.9036
35	118.329	0.8971

Tabla A-E11. Valores (obtenidos experimentalmente con un difrásímetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de Li₂Si₃N₄O₄(O₃) (tinta verde). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

Anexo I (expresión de difracción y sus tablas)

DIFFRAC / AT -- PRINTOUT V1.0 *** 05-May-1997 13:06:18

Dump of file: C:\USBRDATA\YINDS.DIF (05-MAY-1997 12:51:32)
 Sample name : YINDS LINHDXRS (30-oct-1996 08:39:16)
 DSMEAS - Program:MAPEIN.DQL

Wavelength 1: 1.54060
 Wavelength 2: 1.54410

Range # 1		Raw data measured from 2 theta = 0.000 to 110.000	
Step size:	0.010	Time/step:	5.0
Peak width:	0.174	Threshold:	1.0
-N	Z theta	--Cps--	--%
1	23.700	3.7500	100.00
2	34.710	0.7100	18.75
3	34.747	0.7100	18.75
4	38.900	0.3082	3.44
5	40.047	2.2496	69.27
6	42.925	2.1241	61.47
7	48.290	1.8759	116.56
8	53.100	1.6757	72.82
9	55.760	1.6753	7.56
10	58.051	1.6394	87.85
11	57.021	1.6139	24.44
12	61.034	1.5167	85.59
13	62.343	1.4862	30.20
14	68.510	1.3891	40.31
15	71.231	1.3824	28.10
16	73.404	1.3809	19.28
17	76.024	1.3590	26.35
18	78.373	1.3191	29.69
19	79.725	1.2080	40.55
20	81.755	1.1660	16.00
21	82.695	1.1660	20.57
22	83.713	2.1564	8.59
23	86.373	1.1256	31.91
24	86.673	1.1217	5.16
25	87.403	1.1210	6.63
26	92.006	1.0704	15.69
27	92.925	1.0626	7.40
28	93.956	1.0536	12.49
29	98.947	1.0134	9.06
30	99.749	0.6674	14.62
31	103.339	0.6153	14.64
32	105.476	0.5744	22.57
33	105.747	0.5661	3.13

Tabla A E12 Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y 2θ para cada máximo de difracción del espectro de rayos-X de Li₁-xNb₂O₃ (tinta azul). CPS: intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:07:18

Dump of file: C:\USERDATA\YHBDY75.DIF (05-May-1997 12:52:56)
 Sample name : YHBDY75 (24-Oct-1996 04:15:54)
 DSMEAS - Program: MARTIN.DQL

Wavelength 1: 1.54060
 Wavelength 2: 1.54430

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 98.440
 Step size : 0.010 Time/step : 5.0
 Peak width: 0.469 Threshold : 2.5

-N-	2 theta	d	Cps	%
1	23.707	3.7561	1744.29	100.00
2	32.705	2.7360	576.12	33.03
3	36.790	2.5765	395.17	22.65
4	38.990	2.5082	69.34	3.92
5	40.044	2.4298	196.96	11.29
6	42.530	2.1239	254.88	14.61
7	46.485	1.8759	180.91	10.30
8	51.507	1.6192	752.60	43.34
9	56.081	1.5356	243.60	13.97
10	57.003	1.5143	173.31	9.93
11	61.061	1.5163	217.38	12.46
12	62.375	1.4975	183.19	10.50
13	68.542	1.3679	101.55	6.39
14	71.237	1.3227	55.20	3.16
15	73.434	1.2684	48.38	2.78
16	76.036	1.2507	86.95	4.98
17	78.405	1.2187	154.13	8.84
18	79.200	1.2085	87.47	5.01
19	81.752	1.1770	38.15	2.19
20	82.714	1.1658	105.66	6.06
21	83.700	1.1546	32.92	1.89
22	86.400	1.1253	97.32	5.58
23	88.727	1.1017	42.56	2.44
24	92.010	1.0708	78.14	4.48
25	92.978	1.0621	52.62	3.02
26	93.543	1.0537	54.77	3.24

Tabla A-E13. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de Li_{0.85}Nb_{0.15}(D₅₀₀₀O, límite púrpura). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 06-May-1997 13:08:12

Dump of file: C:\USERS\DATA\YNBDY.DIF (05-May-1997 12:53:54)
 Sample name : YNBDY LINRDY1SS (23-Oct-1996 08:01:02)
 D5MEAS - Program: MARTIN.DCL

Wavelength 1: 1.54060
 Wavelength 2: 1.54100

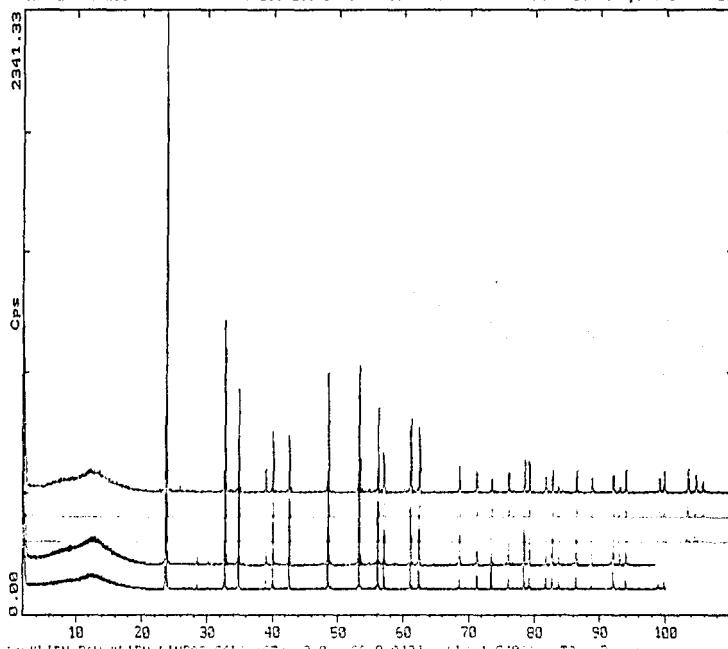
Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 100.000
 Step size : 0.010 Time/step : 5.0
 Peak width: 0.469 Threshold : 2.5

-N-	2 theta	d	Cps	%
1	23.690	3.7527	1087.52	100.00
2	32.696	2.7367	413.20	37.09
3	33.199	2.5974	240.61	19.31
4	39.952	3.0304	33.59	3.61
5	40.034	2.2450	135.73	15.62
6	42.515	2.1246	24.14	1.40
7	48.472	1.8755	261.20	28.34
8	53.219	1.7129	221.20	17.19
9	56.039	1.6307	218.29	17.01
10	56.990	1.6140	109.75	10.09
11	61.031	1.5170	102.16	7.94
12	62.332	1.4684	72.28	5.61
13	68.516	1.3664	38.06	3.00
14	71.212	1.3231	55.32	4.30
15	73.411	1.2985	94.70	7.36
16	76.019	1.2508	44.79	3.48
17	76.384	1.2190	95.38	7.49
18	79.149	1.2096	42.29	3.63
19	81.746	1.1771	45.17	3.83
20	82.687	1.1681	46.34	3.60
21	83.171	1.1544	29.63	2.32
22	86.369	1.1256	51.90	4.02
23	89.687	1.1023	14.44	1.12
24	92.005	1.0708	89.95	5.43
25	92.966	1.0622	12.80	1.07
26	93.944	1.0537	36.29	2.82
27	96.957	1.0133	15.50	1.20
28	99.760	1.0073	26.14	2.19

Tabla A-E14: Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS

D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-

X de la $\text{Li}_{1-x}\text{Nb}_x\text{O}_3$ (linta morada). CPS: intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. Tambien se reportan las condiciones en las cuales se llevo a cabo el barido



A1 YLBN,PAH YLBN LINB03 SOLN (CT: 3.0z, SG:0.0403z, WL: 1.54064p, TC : Room)

A1YHBDY5.PAH YHBDY CT: 5.0z, SG:0.0104z, WL: 1.54064p, TC : Room

A1YHBDY.PAH YHBDY LINB03SS (CT: 5.0z, SG:0.0103z, WL: 1.54064p, TC : Room)

Anexo 1.

Fig. A-E3

Especetros de difraccion de rayos-X de las soluciones solidas de LiNbO₃ con Dy₂O₃.

vease tambien las tablas A-E11, A-E12, A-E13 y A-E14.

Anexo E (Espectros de difracción y sus tablas)

Anexo 1**Espectros de difracción de rayos-X de la figura A-E4**Li_{1-x}Ta_xNd_{1-y}O_y

X	espectro de	Número (orden de arriba hacia abajo)
0.01	Li _{0.99} Ta _{0.01} Nd _{0.99} O ₁	1 (tinta negra)
0.075	Li _{0.925} Ta _{0.075} Nd _{0.925} O ₁	2 (tinta verde)
0.05	Li _{0.95} Ta _{0.05} Nd _{0.95} O ₁	3 (tinta azul)
0.025	Li _{0.975} Ta _{0.025} Nd _{0.975} O ₁	4 (tinta púrpura)
.0	LiTaO ₃	5 (tinta morada)

espectro de	valores de d, 2θ, etc.
Li _{0.99} Ta _{0.01} Nd _{0.99} O ₁	tabla A-E18
Li _{0.925} Ta _{0.075} Nd _{0.925} O ₁	tabla A-E-17
Li _{0.95} Ta _{0.05} Nd _{0.95} O ₁	Tabla A-E16
Li _{0.975} Ta _{0.025} Nd _{0.975} O ₁	tabla A-E15
LiTaO ₃	tabla A-E6

DIFFRAC / AT -- PRINTOP V1.0 *** 05 MAY-1997 13:10:16

Dump of file: C:\USERDATA\YURI125.DIF (05-MAY-1997 12:55:12)
 Sample name: YURI125 (20-sep-1996 04:27:40)
 DSSMAX = Frequency/ANTIN.DOF

Wavelength 1: 1.51960
 Wavelength 2: 1.54470

Range: 1
 Raw data measured from 2. Wavelength: 2.000 to 120.000
 Step size: 0.020 Time/step: 5.0
 Peak width: 0.469 Threshold: 2.5

Nº	θ [θ]	d [d] Å	CPS %	I %
1	21.740	3.7449	101.13	100.00
2	32.853	2.7132	99.01	99.43
3	34.340	2.6578	97.05	98.06
4	39.258	2.2930	124.23	11.20
5	40.321	2.2457	73.70	1.15
6	42.563	2.1223	261.73	11.98
7	48.491	1.6736	354.88	15.09
8	53.425	1.7136	199.63	20.97
9	56.344	1.6914	201.70	12.40
10	58.349	1.6595	107.74	7.99
11	61.117	1.5191	216.03	9.61
12	62.172	1.3876	141.92	5.03
13	68.873	1.3630	97.89	3.16
14	71.678	1.3156	97.72	4.16
15	73.344	1.2864	40.78	1.95
16	74.205	1.2742	73.75	3.53
17	78.482	1.2375	82.66	3.57
18	79.486	1.2010	93.09	3.92
19	82.203	1.1717	46.01	1.96
20	82.760	1.1650	91.72	2.63
21	86.544	1.1237	12.48	2.66
22	89.731	1.1016	32.04	1.20
23	92.106	1.0679	69.56	2.05
24	93.030	1.0616	28.87	1.10
25	93.573	1.0434	55.13	2.35
26	98.992	1.0121	33.72	1.43
27	100.057	1.0051	43.55	1.85
28	103.392	0.9816	43.92	1.87
29	105.526	0.9749	31.76	1.35
30	106.446	0.9706	31.63	1.27
31	110.595	0.9364	24.88	1.06
32	113.556	0.9207	18.97	1.66
33	115.880	0.9069	43.70	1.86
34	117.671	0.9002	29.33	1.25
35	118.420	0.8967	60.89	2.58

Tabla A-E15. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de la muestra (SiO₂, ótala Purpura). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

DIFRAC / AC -- PRINTDIF V1.0 ** 05-MAY-1987 13:11:28

Dump of file: C:\USER\DATA\YLITAS.DIF (05-MAY-1987 22:55:40)
 Sample name: YLITAS.DIF (05-May-1986 10:56:02)
 DOMEAS : Program\HARTCH.DBL

Wavelength 1: 1.54050
 Wavelength 2: 1.54334

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 120.000
 Step size: 0.040 Time/stop: 30.0
 Peak width: 0.400 Threshold: 2.5

-N-	2 theta	Intensity	Spec.	----
1	23.272	3.7090	316.01	100.00
2	31.114	2.7070	149.76	47.27
3	35.021	2.7257	100.00	33.77
4	39.194	2.7229	70.17	21.37
5	40.329	2.7230	15.32	4.93
6	42.786	2.1117	61.20	19.34
7	47.702	2.1065	75.00	24.12
8	53.166	2.0624	102.26	32.85
9	56.249	1.7631	71.02	23.43
10	57.572	1.5899	15.74	11.20
11	61.290	2.5112	64.04	20.13
12	62.914	1.4845	41.60	13.10
13	63.103	1.4846	20.07	7.16
14	71.007	1.3119	21.61	7.51
15	73.537	1.2466	16.23	5.70
16	76.143	1.2464	25.00	8.80
17	78.582	1.2166	31.04	9.79
18	79.145	1.2264	32.24	10.14
19	82.405	1.1694	13.09	4.09
20	82.884	1.1639	24.29	7.65
21	84.570	1.1443	9.26	2.92
22	86.608	1.1222	24.57	7.72
23	88.180	1.1069	14.39	4.79
24	89.170	1.0873	25.81	8.28
25	93.109	1.0610	11.68	3.60
26	93.726	1.0608	21.61	7.00
27	96.032	1.0127	14.21	4.53
28	100.171	1.0043	12.89	4.16
29	104.416	0.9755	19.01	6.25
30	104.416	0.9743	19.01	6.25
31	106.142	0.9592	12.02	3.80
32	110.731	0.9361	11.37	3.59
33	113.641	0.9263	19.96	6.27
34	116.173	0.9195	24.11	7.58
35	117.877	0.9092	14.31	4.72
36	118.372	0.8969	27.63	8.73

Tabla A-E16. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de la muestra D (alta azul). GPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. Tambien se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barido

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:12:40

Dump of file: C:\USERDATA\YLTAN75.DIF (05-May-1997 12:56:46)
 Sample name : LITAND-75EG (21-Sep-1996 17:30:04)
 Old file structure - converted by EVA V3.11

Wavelength 1: 1.54060

Range # 1
 Raw data measured from 2 theta = 2.000 to 100.000
 Step size : 0.020 Time/step : 5.0
 Peak width: 0.760 Threshold : 3.7

N-	2 theta	d	Cps	%
1	23.760	3.7418	13072.62	100.00
2	32.856	2.7237	5537.08	42.36
3	34.775	2.5777	3554.76	27.19
4	39.300	2.2907	664.77	5.09
5	40.106	2.2465	436.52	3.34
6	42.535	2.1216	1875.93	14.35
7	48.564	1.8712	2576.41	19.71
8	53.444	1.7131	1371.28	25.79
9	56.028	1.6400	1846.67	14.13
10	57.383	1.5045	1152.32	8.81
11	59.220	1.5834	119.14	0.91
12	61.077	1.5160	1613.05	12.34
13	62.301	1.4891	903.03	6.91
14	68.855	1.3629	733.94	5.61
15	71.758	1.3143	607.13	4.64
16	73.332	1.2805	355.12	2.71
17	77.152	1.1491	576.12	4.41
18	78.321	1.2190	357.06	4.26
19	79.481	1.2049	774.29	5.92
20	82.220	1.1715	364.01	2.78
21	82.676	1.1662	471.20	3.60
22	84.423	1.1465	161.54	1.24
23	86.478	1.1244	499.12	3.82
24	88.505	1.1029	227.90	1.74
25	92.457	1.0567	509.42	3.90
26	92.920	1.0626	185.36	1.42
27	94.556	1.0477	406.67	3.11
28	99.831	1.0143	230.32	1.76

Tabla A-E17. Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de Li_{4-x}Ta_x_{0.5}Nd_{2-x}O₅ (inta verde). CPS= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. Tambien se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido.

DIFFRAC / AT -- PRINTDIF V1.0 *** 05-May-1997 13:14:26

Dump of file: C:\USERDATA\YVITA188.DIP (05-May-1997 12:57:20)
 Sample name: LITANDISOLEN (05-May-1997 12:57:11:32)
 Old file structure - generated by FVA V3.11

Wavelength 1: 1.54060
 Wavelength 2: 1.54444

Range #: 1
 Raw data measured from θ theta = 1.000 to 119.999
 Step size : 0.020 Time/step : 5.0
 Peak width: 0.760 Threshold : 3.7

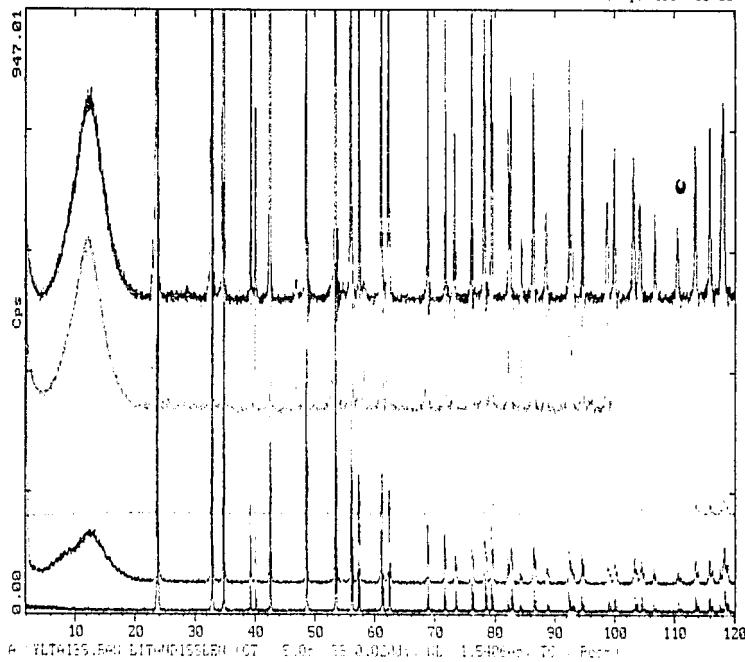
-R#	-2 theta	CPG	%
1	23.712	3.7423	100.00
2	32.855	2.2450	4559.00
3	41.998	1.1622	302.00
4	39.294	2.2591	575.49
5	40.056	2.2492	374.66
6	42.486	2.1263	1315.09
7	48.549	1.6737	2198.00
8	53.424	1.7132	2704.20
9	55.145	1.6845	1548.20
10	57.370	0.6048	1492.17
11	61.019	1.3169	1449.12
12	62.235	1.3055	7391.14
13	68.897	1.3626	648.01
14	71.740	1.3146	515.43
15	73.255	1.2911	131.27
16	79.153	1.1709	507.01
17	78.553	1.2105	515.06
18	79.443	1.2054	640.50
19	82.230	1.1714	342.72
20	82.630	1.1669	424.01
21	81.443	1.1443	171.90
22	86.447	1.1238	473.29
23	86.447	1.1238	3.96
24	92.443	1.0669	455.29
25	91.652	1.0477	387.81
26	98.762	1.0344	231.00
27	99.948	1.0059	311.02
28	103.155	0.9832	297.69
29	104.126	0.9700	251.66
30	106.746	0.9597	210.64
31	110.523	0.9374	193.53
32	113.469	0.9213	411.30
33	115.869	0.9052	345.31
34	118.109	0.8982	376.27

Tabla A-E 18 Valores (obtenidos experimentalmente con un difractómetro de rayos-X SIEMENS

D5000) de d (distancia interplanar) y de 2θ para cada máximo de difracción de el espectro de rayos-X de $\text{Li}_{1-x}\text{Ta}_x\text{Nb}_2\text{O}_6$ (Gota negra). CPG= intensidad integral de los máximos de difracción y % es la intensidad relativa. También se reportan las condiciones en las cuales se llevó a cabo el barrido

2-Theta - Scale

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES. 08-Apr-1997 18:05



A = LTa16.5Ba(LiTaO₃)₆Li₂O (07-00-0001-M1-NL 1.5405-0. TC = Room)

Anexo 1.

Fig. A-E4.

Especetros de difraccion de rayos-X de la serie de soluciones solidas de LiTaO₃ con Nd₂O₃.

Ver tambien las tablas A-E6, A-E15, A-E16, A-E17 y A-E18.

Anexo 2**Resultados de tratamientos térmicos de la línea LiNbO₃-Nd₂O₃**

Proporción molar Li ₂ O-Nb ₂ O ₅ -Nd ₂ O ₃	T (°C)	tiempo en días (aprox.)	resultados	comentarios
50-50-0	900	2	LiNbO ₃	
49.85-49.85-0.25	1050	15	Li _{0.95} Nb _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.75-49.75-0.5	1050	25	Li _{0.95} Nb _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.625-49.625-0.75	1050	45	Li _{0.95} Nb _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.5-49.5-1	1050	60	Li _{0.95} Nb _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida

Resultados de tratamientos térmicos de la línea LiTaO₃-Nd₂O₃

Proporción molar Li ₂ O-Ta ₂ O ₅ -Nd ₂ O ₃	T (°C)	tiempo en días (aprox.)	resultados	comentarios
50-50-0	900	2	LiTaO ₃	
49.85-49.85-0.25	1050	10	Li _{0.95} Ta _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.75-49.75-0.5	1050	15	Li _{0.95} Ta _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.625-49.625-0.75	1050	20	Li _{0.95} Ta _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida
49.5-49.5-1	1050	28	Li _{0.95} Ta _{0.95} Nd _{0.05} O ₃	solución sólida

Resultados de tratamientos térmicos de la línea LiNbO₃-Dy₂O₃

Proporción molar Li ₂ O-Sb ₂ O ₅ -Dy ₂ O ₃	T (°C)	tiempo en días (aprox.)	resultados	comentarios
49.85-49.85-0.25	1050	20	Li _{0.95} Nb _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.75-49.75-0.5	1050	28	Li _{0.95} Nb _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.625-49.625-0.75	1050	45	Li _{0.95} Nb _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.5-49.5-1	1050	67	Li _{0.95} Nb _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida

Resultados de tratamientos térmicos de la línea LiTaO₃-Dy₂O₃

Proporción molar Li ₂ O-Ta ₂ O ₅ -Dy ₂ O ₃	T (°C)	tiempo en días (aprox.)	resultados	comentarios
49.85-49.85-0.25	1050	15	Li _{0.95} Ta _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.75-49.75-0.5	1050	25	Li _{0.95} Ta _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.625-49.625-0.75	1050	43	Li _{0.95} Ta _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida
49.5-49.5-1	1050	50	Li _{0.95} Ta _{0.95} Dy _{0.05} O ₃	solución sólida

AGRADECIMIENTOS.

Antes que nada doy las gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra máxima casa de estudios y en especial a la Facultad de Química, donde me formó.

Agradezco a las siguientes personas las atenciones y apoyo que me brindaron durante el desarrollo de este trabajo:

Dra. Ma. Elena Villalnerte.

Dra. Gracias por toda su asesoría, amistad y confianza brindada a lo largo del desarrollo de este trabajo de tesis.

M en C. Leticia Baños López

Difracción de rayos-X (Departamento de Materiales cerámicos de IIM- UNAM)

Leti gracias por tu apoyo, tu trato amistoso y paciencia para enseñarme a manipular el difractómetro.

Bibliotecaria Sahara Jiménez Cortés

Biblioteca del IIM- UNAM

Sarita simplemente muchísimas gracias

Al Departamento de Materiales Cerámicos del IIM-UNAM

Dr. Luis Felipe del Castillo Jefe del Departamento de Materiales Cerámicos hasta 1996 y

Dr. Raúl Valenzuela Monjarrás jefe actual del departamento.

Departamento de dibujo IIM

Sr. José German y Sr. Eudencio Estrada

M en C. Raúl Escamilla Guerrero

Departamento de Estado sólido y Criogenia I.I.M.-UNAM.

Raúl gracias, tus asesorías siempre me ayudaron a mejorar mi trabajo, pero sobre todo gracias por tu valiosa amistad.

M en C. María A. Castellanos Román

Maestra, gracias por sus sugerencias para el mejoramiento de la discusión de ésta tesis.

Quiero agradecer especialmente a el M en E. C. Ruiz Chiappetto y a la maestra Martha E. Venier por su apoyo moral y académico que me brindaron.

Quiero agradecer a mis compañeros del II Laboratorio de Síntesis de Materiales Cerámicos del I.I.M-UNAM

Con mucho cariño para Yuri Hueda Tamayo (Xuri con 30)

Para todos mis compañeros de la generación de Químicos 90 en especial a

Gaston C. Francisco Bravo de la Mora (Pm... tristal) y Graciela

Alejandra Martinez (C. Los dulos, Edanigas) SERGIO MELENDEZ, Nicanor Vazquez GEMA GEMA LÓPEZ LÓPEZ.

Gisella P., Yamila, Julia, (8'1 81), Cheley M. Maricel Velasquez GRACIELA ESTAROL C. Julia Segura

Cesar V.A. Toxqui, Ericko Varela, S. Uriarte y Olga Luisa Enriquez Huatempa JUAN GUERRA

A. Martinez MELI Tamayo (Meneses), M. Luisa J. A. Guillermo R. y fam

Ally y Maestra Angie B

Es mejor tener un final HORRIBLE, que horrores JUAN FINAL, (Libro de leyes de Murphy).

"El hombre es una
máquina más complicada
que los que él mismo ha
diseñado. No conoce ni
siquiera que va a ocurrir

El hombre ya no se acuerda
a lo seguro - vivimos en
un mundo donde ya nadie
encaja - fuera hay un
mar de osil a la izq.
que nos arrastran a nos
mismos". "te desgraciado"